(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-111569

(43)公開日 平成10年(1998) 4月28日

(51) Int.Cl.6		識別記号	. F I	
G03F	7/039	501	G 0 3 F 7/039 5 0 1	
	7/004	503	7/004 5 0 3	
H01L	21/027		H 0 1 L 21/30 5 0 2 R	

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 33 頁)

(21)出願番号	特願平8 -352621	(71)出願人	000004178
(22)出顧日	平成8年(1996)12月16日		ジェイエスアール株式会社 東京都中央区築地2丁目11番24号
		(72)発明者	諏訪 充史
(31)優先権主張番号	特顧平8-46930		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
(32) 優先日	平8 (1996) 2月9日		成ゴム株式会社内
(33)優先權主張国	日本 (JP)	(72)発明者	梶田 徹
(31)優先権主張番号	特願平8-227344		東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
(32)優先日	平8 (1996) 8月12日		成ゴム株式会社内
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	岩永 伸一郎
			東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合
			成ゴム株式会社内
		(74)代理人	弁理士 福沢 俊明
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感放射線性樹脂組成物

(57)【要約】

とを含有する。

【課題】 化学増幅型レジストとして、特に放射線に対する透明性およびドライエッチング耐性が優れ、しかも基板接着性、感度、解像度、現像性等にも優れたレジストパターンを与える感放射線性樹脂組成物を提供する。 【解決手段】 感放射線性樹脂組成物は、(A)主鎖に脂環式骨格を有する樹脂と、(B) 感放射線性酸発生剤 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 主鎖に脂環式骨格を有する樹脂 と、(B) 放射線の照射により酸を発生する感放射線性 酸発生剤とを含有することを特徴とする感放射線性樹脂 組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感放射線性樹脂組 成物に関わり、さらに詳しくはKFFエキシマレーザー あるいはArFエキシマレーザー等の遠紫外線、シンク 10 ロトロン放射線等のX線、電子線等の荷電粒子線の如き 各種放射線を用いる微細加工に有用な化学増幅型レジス トとして好適に使用することができる感放射線性樹脂組 成物に関する。

[0002]

【従来の技術】集積回路素子の製造に代表される微細加 工の分野においては、より高い集積度を得るために、最 近ではサブハーフミクロンオーダー (0.4 m以下) の微細加工を可能にするリソグラフィー技術の開発が進 められており、近い将来には、サブクオーターミクロン 20 (0.25 μ m以下) レベルでの微細加工技術が必要に なるとされている。従来のリソグラフィープロセスにお いては、一般に放射線としてi線等の近紫外線が用いら れているが、近紫外線ではサブクオーターミクロンレベ ルの微細加工が極めて困難であると言われている。そこ で、サブクオーターミクロンレベルの微細加工を可能と するために、より波長の短い放射線の利用が検討されて いる。このような短波長の放射線としては、例えば水銀 灯の輝線スペクトル、エキシマレーザーに代表される遠 紫外線、X線、電子線等を挙げることができるが、これ 30 らのうち、特にKrFエキシマレーザーあるいはArF エキシマレーザーが注目されている。このようなエキシ マレーザーによる照射に適した感放射線性樹脂組成物と して、酸解離性官能基を有する成分と放射線の照射によ り酸を発生する成分(以下、「酸発生剤」という。)と による化学増幅効果を利用した組成物(以下、「化学増 幅型感放射線性組成物」という。) が数多く提案されて いる。このような化学増幅型感放射線性組成物として は、例えば、特公平2-27660号公報には、カルボ ン酸の t ーブチルエステル基またはフェノールの t ーブ 40 チルカーボナート基を有する重合体と酸発生剤とを含有 する組成物が提案されている。この組成物は、放射線の 照射により発生した酸の作用により、重合体中に存在す る t - ブチルエステル基あるいは t - ブチルカーボナー ト基が開裂して、該重合体がカルボキシル基あるいはフ ェノール性水酸基からなる酸性基を有するようになり、 その結果、レジスト被膜の照射領域がアルカリ現像液に 易溶性となる現象を利用したものである。ところで、従 来の化学増幅型感放射線性組成物の多くは、フェノール

は、放射線として遠紫外線を使用する場合、樹脂中の芳 香族環に起因して遠紫外線が吸収されるため、照射され た遠紫外線がレジスト被膜の下層部まで十分に到達でき ないという欠点があり、そのため照射量がレジスト被膜 の上層部では多く、下層部では少なくなり、現像後のレ ジストパターンが上部が細く下部にいくほど太い台形状 になってしまい、十分な解像度が得られないなどの問題 があった。その上、現像後のレジストパターンが台形状 となった場合、次の工程、即ちエッチングやイオンの打 ち込みなどを行う際に、所望の寸法精度が達成できず、 問題となっていた。しかも、レジストパターン上部の形 状が矩形でないと、ドライエッチングによるレジストの 消失速度が速くなってしまい、エッチング条件の制御が 困難になる問題もあった。一方、レジストパターンの形 状は、レジスト被膜の放射線の透過率を高めることによ り改善することができる。例えば、ポリメチルメタクリ レートに代表される (メタ) アクリレート系樹脂は、遠 紫外線に対しても透明性が高く、放射線の透過率の観点 から非常に好ましい樹脂であり、例えば特開平4-22 6461号公報には、メタクリレート系樹脂を使用した 化学増幅型感放射線性樹脂組成物が提案されている。し かしながら、この組成物は、微細加工性能の点では優れ ているものの、芳香族環をもたないため、ドライエッチ ング耐性が低いという欠点があり、この場合も高精度の エッチング加工を行うことが困難である。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、活性 放射線、例えばKrFエキシマレーザーあるいはArF エキシマレーザーに代表される遠紫外線、に感応する化 学増幅型レジストとして、特に放射線に対する透明性お よびドライエッチング耐性が優れ、かつ基板接着性、感 度、解像度、現像性等にも優れたレジストパターンを与 える感放射線性樹脂組成物を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)主鎖に 脂環式骨格を有する樹脂と、(B)放射線の照射により 酸を発生する感放射線性酸発生剤とを含有することを特 徴とする感放射線性樹脂組成物、からなる。

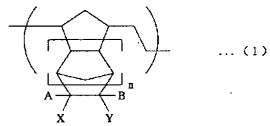
【0005】以下、本発明を詳細に説明する。 樹脂 (A)

本発明で用いられる(A)主鎖に脂環式骨格を有する樹 脂(以下、「樹脂(A)」という。)における脂環式骨 格は、シクロアルカン類に由来する骨格のように単環で も、ビシクロ[2.2.1] ヘプタン、テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカン等に由来する骨 格のように多環でもよく、また、これらの脂環式骨格 は、樹脂(A)中に1種以上存在することができる。前 記脂環式骨格は、酸により開裂する基(以下、「酸開裂 性基」という。)を適宜の位置に1種以上有することが 系樹脂をベースにするものであるが、このような樹脂で 50 でき、また酸開裂性基以外の1種以上の置換基、例え

ば、ハロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭化水素 基、炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基等を 適宜の位置に有することもできる。本発明においては、 樹脂(A)がその主鎖に脂環式骨格を有することによ り、レジストとして、特に放射線に対する透明性および ドライエッチング耐性が優れ、しかも基板接着性、感 度、解像度、現像性等にも優れた感放射線性樹脂組成物 を得ることができる。本発明における樹脂(A)として は、それ自体アルカリ不溶性ないしアルカリ難溶性であ り、酸の作用により開裂する少なくとも1種の酸開裂性 10 基を有し、酸の作用によりアルカリ可溶性となる樹脂が 好ましい。ここでいう「アルカリ不溶性ないしアルカリ 難溶性」とは、本発明の感放射線性樹脂組成物から形成 されたレジスト被膜の現像に使用されるアルカリ水溶液 からなる現像液に対して不溶ないし難溶である性質を意 味する。なお、樹脂(A)のアルカリ溶解性は、例えば カルボキシル基等の酸性官能基の含有率により調節する ことができる。樹脂(A)における好ましい脂環式骨格 は、下記一般式(1)または一般式(2)で表される骨 格であり、特に下記一般式(1)で表される骨格が好ま 20 LVI

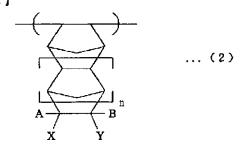
[0006]

【化1】



[0007]

【化2】



【0008】 [一般式(1) および一般式(2) におい て、nは0または1であり、AおよびBはそれぞれ独立 に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭 化水素基または炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化 水素基を示し、XおよびYはそれぞれ独立に水素原子、 ハロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基、炭 素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基または酸開 裂性基を示し、かつXおよびYのうち少なくとも一つは 酸開裂性基である。〕

酸開裂性基としては、基-(CH2), COOR1、-(CH2), OCOR ² もしくは -(CH₂); CN (但し、R¹は炭素数1~10の 炭化水素基、炭素数1~10のハロゲン化炭化水素基、 テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、カ ルボブトキシメチル基、カルボブトキシエチル基、カル ボブトキシプロピル基もしくはトリアルキリルシリル基 (但し、アルキル基の炭素数は1~4である。)を示 し、R²は炭素数1~10の炭化水素基または炭素数1~ 10のハロゲン化炭化水素基を示し、iは0~4の整数 である。}、またはXおよびYが脂環式骨格中の炭素原 子と結合して形成した、式

[0009]

【化7】

【0010】 {但し、Zは -0-または -N(R3)- (但し、 R3は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~8のアルキル 基もしくは炭素数1~4の -SO₂R⁴(但し、R⁴は炭素数1 ~4のアルキル基もしくは炭素数1~4のハロゲン化ア ルキル基である。))を示す。)で表される含酸素複素 環構造あるいは含窒素複素環構造が好ましい。一般式 (1) および一般式(2) におけるXおよびYの好まし い酸開裂性基において、基-(CH₂), COOR¹ としては、例 えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、 nープロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニ ル基、n-ブトキシカルボニル基、2-メチルプロポキ シカルボニル基、1-メチルプロポキシカルボニル基、 t-ブトキシカルボニル基、n-ペンチルオキシカルボ ニル基、n-ヘキシルオキシカルボニル基、n-ヘプチ 30 ルオキシカルボニル基、n-オクチルオキシカルボニル 基、n-デシルオキシカルボニル基、シクロペンチルオ キシカルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル 基、4-t-ブチルシクロヘキシルオキシカルボニル 基、シクロヘプチルオキシカルボニル基、シクロオクチ ルオキシカルボニル基等の(シクロ)アルコキシカルボ ニル基:フェノキシカルボニル基、4-t-ブチルフェ ノキシカルボニル基、1ーナフチルオキシカルボニル基 等のアリーロキシカルボニル基;ベンジルオキシカルボ ニル基、4-tーブチルベンジルオキシカルボニル基等 40 のアラルキルオキシカルボニル基;メトキシカルボニル メチル基、エトキシカルボニルメチル基、n-プロポキ シカルボニルメチル基、イソプロポキシカルボニルメチ ル基、nーブトキシカルボニルメチル基、2ーメチルプ ロポキシカルボニルメチル基、1-メチルプロポキシカ ルボニルメチル基、t-ブトキシカルボニルメチル基、 シクロヘキシルオキシカルボニルメチル基、4-t-ブ チルシクロヘキシルオキシカルボニルメチル基等の(シ クロ)アルコキシカルボニルメチル基;フェノキシカル ボニルメチル基、1ーナフチルオキシカルボニルメチル 一般式(1) および一般式(2) におけるXおよびYの 50 基等のアリーロキシカルボニルメチル基; ベンジルオキ

シカルボニルメチル基、4-t-ブチルベンジルオキシ カルボニルメチル基等のアラルキルオキシカルボニルメ チル基;2-メトキシカルボニルエチル基、2-エトキ シカルボニルエチル基、2-n-プロポキシカルボニル エチル基、2-イソプロポキシカルボニルエチル基、2 -n-ブトキシカルボニルエチル基、2-(2-メチル プロポキシ)カルボニルエチル基、2-(1-メチルプ ロポキシ) カルボニルエチル基、2-t-ブトキシカル ボニルエチル基、2-シクロヘキシルオキシカルボニル エチル基、2-(4-ブチルシクロヘキシルオキシカル 10 ボニル) エチル基等の (シクロ) アルコキシカルボニル エチル基;2-フェノキシカルボニルエチル基、2-(1-ナフチルカルボニル) エチル基等の2-アリーロ キシカルボニルエチル基;2ーベンジルオキシカルボニ ルエチル基、2-(4-t-ブチルベンジルオキシカル ボニル) エチル基等の2-アラルキルオキシカルボニル エチル基等を挙げることができる。これらの基のうち、 基-COOR1 に相当するものが好ましく、さらに好ましく は(シクロ)アルコキシカルボニル基であり、特に好ま しくはメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、 nーブトキシカルボニル基、tーブトキシカルボニル 基、シクロヘキシルオキシカルボニル基である。

【0011】また、基-(CH₂)_i 0COR² としては、例え ば、アセチルオキシ基、プロピオニルオキシ基、ブチリ ルオキシ基、バレリルオキシ基、カプロイルオキシ基、 ヘプタノイルオキシ基、オクタノイルオキシ基、ノナノ イルオキシ基、デカノイルオキシ基、ウンデカノイルオ キシ基、シクロヘキシルカルボニルオキシ基、4-t-ブチルシクロヘキシルカルボニルオキシ基等の(シク ロ) アシロキシ基:ベンゾイルオキシ基、4-t-ブチ ルベンゾイルオキシ基、1-ナフトイルオキシ基等のア リールカルボニルオキシ基;ベンジルカルボニルオキシ 基、4-t-ブチルベンジルカルボニルオキシ基等のア ラルキルカルボニルオキシ基;アセチルオキシカルボニ ルメチル基、プロピオニルオキシカルボニルメチル基、 ブチリルオキシカルボニルメチル基、シクロヘキシルカ ルボニルオキシメチル基、4-t-ブチルシクロヘキシ ルカルボニルオキシメチル基等の(シクロ)アシロキシ メチル基;ベンゾイルオキシメチル基、1-ナフトイル オキシメチル基等のアリールカルボニルオキシメチル 基:ベンジルカルボニルオキシメチル基、4-t-ブチ ルベンジルカルボニルオキシメチル基等のアラルキルカ ルボニルオキシメチル基;2-アセチルオキシエチル 基、2-プロピオニルオキシエチル基、2-ブチリルオ キシエチル基、2-シクロヘキシルカルボニルオキシエ チル基、2-(4-t-ブチルシクロヘキシルカルボニ ルオキシ) エチル基等の2-(シクロ) アシロキシエチ ル基;2-ベンゾイルオキシエチル基、2-(1-ナフ トイルオキシ) エチル基等の2-アリールカルボニルオ キシエチル基;2-ベンジルカルボニルオキシエチル

基、2-(4-t-ブチルベンジルカルボニルオキシ) エチル基等の2-アラルキルカルボニルオキシエチル基 等を挙げることができる。また、基-(CH₂); CNとして は、例えば、シアノ基、シアノメチル基、2-シアノエ チル基、2-シアノプロピル基、3-シアノプロピル 基、4-シアノブチル基等を挙げることができる。

6

【0012】さらに、一般式(1)および一般式(2) におけるA、B、XおよびYのハロゲン原子としては、 例えば、F、C1、Br、1等を挙げることができ、ま た炭素数1~10の1価の炭化水素基としては、例え ば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピ ル基、n-ブチル基、2-メチルプロピル基、1-メチ ルプロピル基、tーブチル基、nーヘキシル基、nーオ クチル基、nーデシル基、シクロペンチル基、シクロヘ キシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基等の (シクロ) アルキル基;フェニル基、4-t-ブチルフ エニル基、1-ナフチル基等のアリール基;ベンジル 基、4-t-ブチルベンジル基等のアラルキル基等を挙 げることができ、また炭素数1~10の1価のハロゲン 化炭化水素基としては、例えば、前記炭素数1~10の 1価の炭化水素基のハロゲン化誘導体を挙げることがで きる。樹脂(A)において、一般式(1)または一般式 (2) で表される脂環式骨格は、それぞれ1種以上存在 することができ、また一般式(1)で表される脂環式骨 格と一般式(2)で表される脂環式骨格とが併存するこ ともできる。

【0013】主鎖に一般式(1) または一般式(2) で表される脂環式骨格を有する樹脂(A)(以下、「樹脂(AI)」という。)は、例えば、下記(I)~(I)の方法等により製造することができる。

(イ)下記一般式(7)で表される少なくとも1種のノルボルネン誘導体(以下、「ノルボルネン誘導体

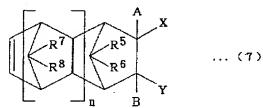
(a)」という。)を、場合により、開環共重合が可能な少なくとも1種の他の不飽和脂環式化合物とともに、 開環(共)重合する工程を経る方法、

[0014]

【化8】

40

50



【0015】 [-般式(7) において、n、A、B、X およびYは-般式(1) および-般式(2) と同義であり、 R^5 、 R^6 、 R^7 および R^8 はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数 $1\sim1001$ 価の炭化水素基または炭素数 $1\sim1001$ 価のハロゲン化炭化水素基を示す。〕

(ロ) 少なくとも1種のノルボルネン誘導体(a) と、

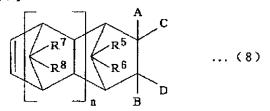
エチレン、無水マレイン酸等の共重合可能な1種以上の 不飽和化合物とを、ラジカル共重合する方法、(ハ)前 記(イ)または(ロ)の方法により得られた各樹脂を、 常法により部分的に加水分解および/または加溶媒分解 する方法、(二)前記(ハ)の方法により得られた樹脂 中のカルボキシル基あるいはヒドロキシル基を、常法に より少なくとも部分的にエステル化して、基 -COOR1 あ るいは -OCOR2 (以下、これらの基をまとめて「酸開裂 性エステル基」という。)を新たに導入する方法、

(ホ) 下記一般式(8) で表される少なくとも1種のノ 10 ルボルネン誘導体(以下、「ノルボルネン誘導体

(b)」という。)を開環(共)重合あるいはラジカル 共重合して得られた (共) 重合体中のカルボキシル基あ るいはヒドロキシル基を、常法により少なくとも部分的 にエステル化して、酸開裂性エステル基を導入する工程 を経る方法。

[0016]

【化9】



【0017】 [一般式 (8) において、n、AおよびB は一般式(1)および一般式(2)と同義であり、R ⁵、R⁶、R⁷ およびR⁸ は一般式(7) と同義であ り、CおよびDはそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原 子、炭素数1~10の1価の炭化水素基、炭素数1~1 0の1価のハロゲン化炭化水素基、-(CH₂)、COOHまたは 30 -(CH₂),OHを示し、かつCおよびDのうち少なくとも-つは-(CH₂): COOHまたは-(CH₂): OHであり、iは一般式 (1) および一般式(2)の酸開裂性基におけるiと同 義である。〕

さらに、前記(ハ)~(ホ)の方法により得られた各樹 脂は、(へ) 樹脂中のカルボキシル基あるいはヒドロキ シル基をさらにエステル化して、他の酸開裂性基を導入 する方法等により変性することもできる。

【0018】以下、前記(イ)~(へ)の方法につい て、順次説明する。まず、前記(イ)の方法において、 一般式 (7) におけるR⁵、R⁶、R⁷ およびR⁸ のハ ロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基および 炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基として は、例えば、前記一般式(1)および一般式(2)につ いて例示した基と同様のものを挙げることができる。

【0019】ノルボルネン誘導体(a)のうち、一般式 (7) のnが0である化合物の具体例としては、5-メ トキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-エトキシカルボニルビシクロ[2.2.1] $^{\sim}$ プトー2ーエン、 $^{\circ}$ 5 $^{\circ}$ n $^{\circ}$ プロポキシカルボニルビシ $^{\circ}$ 50 $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ 1 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 2 $^{\circ}$ 3 $^{\circ}$ 4 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 7 $^{\circ}$ 8 $^{\circ}$ 9 $^$

クロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーイソプロポ キシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエ ン、5-n-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2. 1] $^{-1}$ カルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、 5- (1-メチルプロポキシ) カルボニルビシクロ[2. 2. 1] $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ $^{-2}$ ボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ー シクロヘキシルオキシカルボニルビシクロ[2.2. 1] ヘプト-2-エン、5-(4'-tーブチルシクロ ヘキシルオキシ) カルボニルビシクロ[2.2.1] ヘ プトー2-エン、5-フェノキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーテトラヒドロフラ ニルオキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5-テトラヒドロピラニルオキシカルボニル ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーアセチ ルオキシビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5 ーシアノビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、 【0020】5-メチル-5-メトキシカルボニルビシ 20 クロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-メチル-5 ーエトキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5-メチル-5-n-プロポキシカルボニル ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5-メチル -5ーイソプロポキシカルボニルビシクロ「2.2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーnーブトキシ カルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、 5-メチル-5-(2-メチルプロポキシ)カルボニル ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5-メチル -5-(1-メチルプロポキシ)カルボニルビシクロ[ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2 ーエン、5-メチルー5-シクロヘキシルオキシカルボ ニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメ チルー5-(4'-t-ブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、 5-メチルー5-フェノキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーテトラヒ ドロフラニルオキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーテトラヒドロピラ 40 ニルオキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー 2-エン、5-メチル-5-アセチルオキシビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5ーメチルー5ーシア ノビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5,6-ジ(メトキシカルボニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプ トー2ーエン、5,6ージ(エトキシカルボニル)ビシ ープロポキシカルボニル)ビシクロ[2.2.1]ヘプ

トー2ーエン、5、6ージ (イソプロポキシカルボニ

ル) ビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン、5、6

1] ヘプト-2-エン、5, 6-ジ(t-ブトキシカル ボニル) ビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、 5, 6-ジ(フェノキシカルボニル) ビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、5, 6ージ (テトラヒドロ フラニルオキシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]へ プトー2ーエン、5、6ージ (テトラヒドロピラニルオ キシカルボニル) ビシクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン、5、6-ジカルボキシアンハイドライドビシクロ [2.2.1] ヘプトー2ーエン等を挙げることができ る。

【0021】また、ノルボルネン誘導体(a)のうち、 一般式(7)のnが1である誘導体の具体例としては、 8-メトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 ^{2.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8ーエトキシカルボ ニルテトラシクロ[4 . 4 . 0 . $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデ カー3-エン、8-n-プロポキシカルボニルテトラシ クロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエ ン、8-イソプロポキシカルボニルテトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8-n-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1] ^{2.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8ー(2ーメチルプ ロポキシ) カルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 ^{2.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8- (1ーメチルプ ロポキシ) カルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2.5}$. $1^{7.10}$] \vec{r} \vec{r} ルボニルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] ドデカー3-エン、8-シクロヘキシルオキシカルボニ ルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,10}$]ドデカ -3-エン、8-(4'-t-ブチルシクロヘキシルオ キシ) カルボニルテトラシクロ[4 . 4 . 0 . 1^{2.5} . 17.10]ドデカー3ーエン、8ーフェノキシカルボニル テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー 3-エン、8-テトラヒドロフラニルオキシカルボニル テトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3 - ド デセン、8-テトラヒドロピラニルオキシカルボニルテ トラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3 - ドデ セン、8-アセチルオキシテトラシクロ[4.4.0. $1^{2.5} \cdot 1^{7.10}$] $| FFD - 3 - IV \cdot 8 - 5P / F + 5$ シクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10]ドデカー3ーエ

【0022】8-メチル-8-メトキシカルボニルテト ラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ー エン、8-メチル-8-エトキシカルボニルテトラシク ロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-n-プロポキシカルボニルテトラシク Γ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-イソプロポキシカルボニルテトラシク ロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-n-プトキシカルボニルテトラシクロ [4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8 50 ては、ビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー2ーエン、ビシ

ーメチルー8ー(2ーメチルプロポキシ)カルボニルテ トラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]ドデカー3 ーエン、8ーメチルー8ー(1ーメチルプロポキシ)カ ルボニルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] ドデカー3-エン、8-メチル-8-t-ブトキシカル ボニルテトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5} . 1^{7.10}]ド デカー3-エン、8-メチル-8-シクロヘキシルオキ シカルボニルテトラシクロ[$4.4.0.1^{2.5}.1$] ^{7.10}]ドデカー3ーエン、8ーメチルー8ー(4'ー t 10 ーブチルシクロヘキシルオキシ) カルボニルテトラシク $D[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデカー3ーエン、 8-メチル-8-フェノキシカルボニルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8ー メチルー8ーテトラヒドロフラニルオキシカルボニルテ トラシクロ[4.4.0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3 - ドデ セン、8-メチル-8-テトラヒドロピラニルオキシカ ルボニルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] -3-ドデセン、8-メチル-8-アセチルオキシテト ラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ー 20 エン、8-メチル-8-シアノテトラシクロ[4.4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] $| \vec{r} \vec{r} \vec{p} - 3 - \vec{x} \vec{v}$. $8.9 - \vec{v}$ (メトキシカルボニル) テトラシクロ[4.4.0.1 ^{2.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8, 9ージ (エトキ シカルボニル) テトラシクロ[4.4.0.12.5.1 $^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8、9ージ (n-7)ロポキシ カルボニル) テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1 ^{7.10}]ドデカー3ーエン、8, 9ージ(イソプロポキシ カルボニル) テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1 $^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8、9ージ(nーブトキシカ ルボニル) テトラシクロ[$4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}$]ドデカー3-エン、8、9-ジ(t-ブトキシカルボ ニル) テトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ド デカー3ーエン、8,9ージ(シクロヘキシルオキシカ ルボニル) テトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8,9-ジ(フェノキシカルボニ ル) テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデ カー3ーエン、8,9ージ (テトラヒドロフラニルオキ シカルボニル) テトラシクロ[4.4.0.12.5.1] ^{7,10}] - 3 - ドデセン、8, 9 - ジ(テトラヒドロピラ ニルオキシカルボニル) テトラシクロ[4.4.0.1 ^{2.5} . 1^{7.10}]-3-ドデセン、8, 9-ジカルボキシ アンハイドライドテトラシクロ[$4.4.0.1^{2.5}$. 17.10]ドデカー3ーエン等を挙げることができる。本 発明において、前記ノルボルネン誘導体(a)を2種以 上混合して使用する場合は、一般式 (7) のnが0であ る化合物とnが1である化合物とを併用することが好ま LV

【0023】さらに、ノルボルネン誘導体(a)との開 環共重合が可能な他の不飽和脂環式化合物の具体例とし

クロ[2.2.1] ヘプトー2ーエンー5ーカルボキシ リックアシド、5-メチルビシクロ[2.2.1] ヘプ トー2-エンー5-カルボキシリックアシド、5-メチ ルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、5ーエチ ルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン、テトラシ クロ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7,10}]ドデカー3ーエ ン、テトラシクロ $[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]$ ドデ カー3-エン-8-カルボキシリックアシド、8-メチ ルテトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]ドデカ -3-エン-8-カルボキシリックアシド、8-メチル 10 テトラシクロ [4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}]ドデカー 3-エン、8-エチルテトラシクロ[4.4.0.1] ^{2,5} . 1^{7,10}]ドデカー 3 ーエン、8 ーフルオロテトラ シクロ[4. 4. 0. 12.5 . 17.10]ドデカー3ーエ ン、8-フルオロメチルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2.5}$. $1^{7.10}$] \ddot{F} \ddot{F} ルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカ -3-エン、8-トリフルオロメチルテトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8ー ペンタフルオロエチルテトラシクロ[4.4.0.1] ^{2.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8, 8ージフルオロ テトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー 3-エン、8, 9-ジフルオロテトラシクロ[4.4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8, 8ービス (トリフルオロメチル) テトラシクロ[4.4.0.1 ^{2.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8, 9ービス (トリ フルオロメチル) テトラシクロ[$4.4.0.1^{2.5}$. $1^{7.10}$] ドデカー3-エン、8-メチル-8-トリフル オロメチルテトラシクロ[4.4.0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカー3ーエン、8,8,9ートリフルオロテトラ 30 シクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー3ーエ ン、8,8,9-トリス(トリフルオロメチル)テトラ $900[4.4.0.1^{2.5}]$ ン、8,8,9,9-テトラフルオロテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] \ddot{r} $\ddot{r$ 8, 9, 9ーテトラキス (トリフルオロメチル) テトラ シクロ[4. 4. 0. 12.5. 17.10]ドデカー3ーエ ン、8、8-ジフルオロ-9、9-ビス(トリフルオロ メチル) テトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] ドデカー3-エン、8, 9-ジフルオロー8, 9-ビス 40 (トリフルオロメチル) テトラシクロ[4.4.0.1 ^{2.5} . 1^{7.10}]ドデカー3ーエン、8, 8, 9ートリフ ルオロー9ートリフルオロメチルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] \ddot{r} \ddot{r} 9-トリフルオロ-9-トリフルオロメトキシテトラシ 20^{-1} 2^{-1} 2^{-1} 2^{-1} 2^{-1} 2^{-1} 2^{-1} 2^{-1} 2^{-1} ン、8、8、9-トリフルオロー9-ペンタフルオロプ ロポキシテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$] ドデカー3-エン、8-フルオロー8-ペンタフルオロ

【0024】シクロブテン、シクロペンテン、シクロオ クテン、1,5-シクロオクタジエン、1,5,9-シ クロドデカトリエン、ノルボルネン、5ーエチリデンノ ルボルネン、5ーメチルノルボルネン、ジシクロペンタ ジエン、トリシクロ[5.2.1.0^{2.6}] デカー8-エン、トリシクロ[5.2.1.0 $^{2.6}$] デカー3ーエ ン、トリシクロ[4.4.0. $1^{2.6}$] ウンデカー3ー エン、トリシクロ[6.2.1.0^{1.8}] ウンデカー9 ーエン、トリシクロ[6.2.1.0^{1.8}] ウンデカー 4-xン、テトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}. 1^{7.10}. 0^{1.6}] ドデカー3-エン、8-メチルテトラ シクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$. $0^{1.6}$]ドデカ -3-エン、8-エチリデンテトラシクロ[4.4. 0. $1^{2,5}$. $1^{7,12}$] $|\vec{r}\vec{r}| - 3 - x + y = 0$ ンテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$. 0 ^{1.6}] ドデカー3ーエン、ペンタシクロ[6.5.1. $1^{3.6}$. $0^{2.7}$. $0^{9.13}$]ペンタデカー4ーエン、ペン タシクロ[7. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{9.12}$. $0^{8.13}$]ペン タデカー3-エン等を挙げることができる。樹脂 (A 1) において、前記他の不飽和脂環式化合物に由来する 繰返し単位の含有量は、樹脂(AI)中の全繰返し単位 に対して、通常、50モル%以下、好ましくは40モル %以下、さらに好ましくは30モル%以下である。この 場合、他の不飽和脂環式化合物に由来する繰返し単位の 含有量が50モル%を超えると、ドライエッチング耐性 が低下する傾向がある。

キシハロゲン化物、アルコキシハロゲン化物、アルコキ シド、カルボン酸塩、 (オキシ) アセチルアセトネー ト、カルボニル錯体、アセトニトリル錯体、ヒドリド錯 体や、これらの化合物の誘導体等を挙げることができ る。これらの化合物のうち、WまたはMoの化合物、よ り具体的にはWまたはMoのハロゲン化物、オキシハロ ゲン化物またはアルコキシハロゲン化物が、重合活性、 実用性等の観点から好ましい。また、特定遷移金属化合 物は、適当な錯化剤、例えば、トリフェニルホスフィン (P(C₆H₅)₃)、ピリジン (NC₅H₅)等により配位された化 10 合物であることもできる。特定遷移金属化合物の具体例 としては、WCle、WCls、WCla、WBre、WFe 、WIe 、MoCl 5 、MoCl4 、MoCl3 、ReCl3 、WOCl4 、WOCl3 、WOBr 3 MoOCl3 MoOBr3 ReOCl3 ReOBr3 WCl2 (OC2H5)4 $W(OC_2H_5)_6$, $MoCl_3(OC_2H_5)_2$, $Mo(OC_2H_5)_5$, $WO_2(acac)_2$ (但し、acacはアセチルアセトネート残基を示す。)、 MoO₂(acac)₂、W(OCOR)₅(但し、OCORはカルボン酸残基 を示す。)、Mo(OCOR)s、W(CO)s、Mo(CO)s、Re2(CO) $_{10}$, $WCl_5 \cdot P(C_6H_5)_3$, $MoCl_5 \cdot P(C_6H_5)_3$, $ReOBr_3 \cdot P(C_6H_5)_3$ $H_5)_3$, $WCl_6 \cdot NC_5H_5$, $W(CO)_5 \cdot P(C_6H_5)_3$, $W(CO)_3 \cdot (CH_3)_3$ CN) 3等を挙げることができる。これらの化合物のうち、 特にWCl₆、MoCl₅ 、WCl₂(OC₂H₅)₄、MoCl₃(OC₂H₅)₂ 等が

好ましい。前記特定遷移金属化合物は、単独でまたは2

種以上を組み合せて使用することができる。また、メタ

セシス触媒を構成する特定遷移金属化合物成分は、重合

系内で反応して特定遷移金属化合物を生成する2種以上

の化合物の混合物として使用することもできる。

【0026】次に、特定有機金属化合物等の具体例とし Tit, n-C4H9Li, n-C5H11Na, C6H5Na, CH3MgI, C2H5Mg Br, CH_3MgBr , $n-C_3H_7MgCl$, $t-C_4H_9MgCl$, $CH_2=CHCH_2MgC$ 1 、 $(C_2H_5)_2Z_1$ 、 $(C_2H_5)_2Cd$ 、 $CaZ_1(C_2H_5)_4$ 、 $(CH_3)_3B$ $(C_2H_5)_3B$, $(n-C_4H_9)_3B$, $(CH_3)_3A1$, $(CH_3)_2A1C1$, CH_3 $AlCl_2$, $(CH_3)_3Al_2Cl_3$, $(C_2H_5)_3Al$, $(C_2H_5)_3Al_2Cl_3$, $(C_2H_5)_2Al \cdot O(C_2H_5)_2$, $(C_2H_5)_2AlCl$, $C_2H_5AlCl_2$, $(C_2H_5)_2AlCl$ $H_5)_2A1H$, $(C_2H_5)_2A10C_2H_5$, $(C_2H_5)_2A1CN$, LiA1 $(C_2H_5)_2$ $(n-C_3H_7)_3Al$ $(i-C_4H_9)_3Al$ $(i-C_4H_9)_2AlH$ $(n-C_6)_3Al$ H_{13})₃Al, $(n-C_8H_{17})_3$ Al, $(C_6H_5)_3$ Al, $(CH_3)_4$ Ga, (CH_3) 4Sn、(n-C4H₉)4Sn 、(C2H₅)3SnH、LiH 、NaH 、B2H₆、N aBH4、AlH3、LiAlH4、TiH4等を挙げることができる。 これらの化合物のうち、(CH₃)₃A1、(CH₃)₂A1C1、CH₃A1C l_2 , $(CH_3)_3Al_2Cl_3$, $(C_2H_5)_3Al$, $(C_2H_5)_2AlCl$, C_2H_5Al Cl_2 , $(C_2H_5)_3Al_2Cl_3$, $(C_2H_5)_2AlH$, $(C_2H_5)_2Al0C_2H_5$, $(C_2H_5)_2A1CN$, $(n-C_3H_7)_3A1$, $(i-C_4H_9)_3A1$, $(i-C_4H_9)$ zAlH、(n-CeH13)3Al、(n-CeH17)3Al、(CeH5)3Al 等が好 ましい。前記特定有機金属化合物等は、単独でまたは2 種以上を組み合せて使用することができる。特定遷移金 属化合物と特定有機金属化合物等との量的関係は、金属 原子比として、通常、特定遷移金属化合物:特定有機金 属化合物等が、通常、1:1~1:100、好ましくは 1:2~1:50の範囲である。

【0027】前記特定遷移金属化合物と特定有機金属化 合物等との組み合せからなる触媒には、触媒活性を高め

るため、下記活性化剤①~⑨の1種以上をさらに添加することもできる。

14

活性化剤①: B、BF₃、BCl₃、B(O-n-C₄H₉)₃、BF₃・0 (CH₃)₂、BF₃・0(C₂H₅)₂、BF₃・0 (n-C₄H₉)₂、BF₃・2 C₆H₅OH 、BF₃・2CH₃COOH、BF₃・CO(NH₂)₂、BF₃・N(C₂H₄OH)₃、BF₃・ピペリジン、BF₃・NH₂C₂H₅、B₂O₃、H₃B O₃等のほう素化合物;Si(OC₂H₅)₄、Si(Cl)₄等のけい素化合物、

活性化剤②:アルコール類、ヒドロパーオキシド類、ジアルキルパーオキシド類、ジアシルパーオキシド類、

活性化剤③:水、

活性化剤④:酸素、

活性化剤⑤:アルデヒド類、ケトン類等のカルボニル化 合物や、それらのオリゴマーまたはポリマー、

活性化剤⑥:エチレンオキシド、エピクロルヒドリン、 オキセタン等の環状エーテル類、

活性化剤②:N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド等のアミド類;アニリン、モルホリン、ピペリジン等のアミン類;アゾベンゼン等のアゾ化合物、活性化剤③:N-ニトロソジメチルアミン、N-ニトロソジフェニルアミン等のN-ニトロソ化合物、

活性化剤⑨:トリクロロメラミン、N-クロロスクシンイミド、フェニルスルフェニルクロリド等の窒素-塩素結合または硫黄-塩素結合を有する化合物。

これらの活性化剤と特定遷移金属化合物との量的関係は、使用される活性化剤の種類によって極めて多様に変化するため、一概には規定できないが、多くの場合、モル比として、活性化剤:特定遷移金属化合物が、通常、0.005:1~10:1、好ましくは0.05:1~3.0:1の範囲である。

【0028】(イ)の方法における開環(共)重合によ って得られる樹脂(AI)の平均分子量は、メタセシス 触媒の種類や濃度、重合温度、溶媒の種類や量、モノマ 一濃度等の反応条件を変えることにより調節することが できるが、適当な分子量調節剤を反応系に適量添加して 調節することが好ましい。前記分子量調節剤としては、 例えば、エチレン、プロピレン、1-ブテン、1-ペン テン、1-ヘキセン、1-ヘプテン、1-オクテン、1 - ノネン、1-デセン等のα-オレフイン類;1,3-ブタジエン、1, 4-ペンタジエン等の α , ω -ジオレ フィン類;スチレン、α-メチルスチレン等のビニル芳 香族化合物;アセチレン類;塩化アリル、酢酸アリル、 トリメチルアリロキシシラン等の極性アリル化合物等を 挙げることができる。これらの分子量調節剤は、単独で または2種以上を混合して使用することができる。分子 量調節剤の使用量は、全モノマー1モルに対して、通 常、0.005~2モル、好ましくは0.02~1.0 50 モル、さらに好ましくは0.03~0.7モルである。

(9)

16

また、(イ)の方法に使用される溶媒としては、例え ば、nーペンタン、nーヘキサン、nーヘプタン、nー オクタン、n-ノナン、n-デカン等のアルカン類;シ クロヘキサン、シクロヘプタン、シクロオクタン、デカ リン、ノルボルナン等のシクロアルカン類;ベンゼン、 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、クメン等の芳香 族炭化水素類; クロロブタン、ブロモヘキサン、ジクロ ロエタン、ヘキサメチレンジブロミド、クロロベンゼン 等のハロゲン化炭化水素類;酢酸エチル、酢酸 n ーブチ ル、酢酸 i ーブチル、プロピオン酸メチル等の飽和カル 10 ボン酸エステル類等を挙げることができる。これらの溶 媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用することが

できる。 【0029】また、前記(ロ)の方法におけるラジカル 共重合は、例えば、ヒドロパーオキシド類、ジアルキル パーオキシド類、ジアシルパーオキシド類、アゾ化合物 等のラジカル重合触媒を使用し、適当な溶媒中で実施す ることができる。 (ロ) の方法に使用される溶媒として は、例えば、前記(イ)の方法について例示した溶媒の ほか、テトラヒドロフラン等を挙げることができる。こ れらの溶媒は、単独でまたは2種以上を混合して使用す ることができる。また、前記(ハ)の方法における加水 分解率は、通常、10~100モル%、好ましくは20 ~95モル%である。また、前記(ニ)の方法による酸 開裂性エステル基の導入率は、通常、10~70モル %、好ましくは20~60モル%である。また、前記 (ホ)の方法において、一般式(8)におけるCおよび Dのハロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基 および炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基と しては、例えば、前記一般式(1)および一般式(2) について例示した基と同様のものを挙げることができ る。ノルボルネン誘導体(b)としては、前記ノルボル ネン誘導体(a)について例示した化合物中のエステル 基をカルボキシル基またはヒドロキシル基に転換した化 合物を挙げることができる。本発明においては、ノルボ ルネン誘導体(b)を2種以上混合して使用する場合 も、一般式(8)のnが0である化合物とnが1である 化合物とを併用することが好ましい。(ホ)の方法に使 用される(共)重合体は、前記(イ)または(ロ)の方 法により得られた各樹脂 (AI) を加水分解して得るこ 40 とができ、あるいは別途合成してもよい。(ホ)の方法 による酸開裂性エステル基の導入率は、通常、10~7 0モル%、好ましくは20~60モル%である。さら に、前記(へ)の方法において、他の酸開裂性基として は、例えば、メトキシメチルオキシ基、エトキシメチル オキシ基、n-プロポキシメチルオキシ基、イソプロポ キシメチルオキシ基、n-ブトキシメチルオキシ基、t ーブトキシメチルオキシ基、フェノキシメチルオキシ 基、トリクロロエトキシメチルオキシ基等の線状アセタ ール基;テトラヒドロフラニルオキシ基、テトラヒドロ 50 付加触媒のうち、不均一系触媒としては、例えば、Pd、

ピラニルオキシ基等の環状アセタール基;イソプロポキ シカルボニルオキシ基、2-ブテニルオキシカルボニル オキシ基、tーブトキシカルボニルオキシ基、1ーメチ ルー2ープロペニルオキシカルボニルオキシ基、シクロ ヘキシルオキシカルボニルオキシ基、2-シクロヘキセ ニルオキシカルボニルオキシ基等のカーボネート基;ト リメトキシメチルオキシ基、トリエトキシメチルオキシ 基、トリn-プロポキシメチルオキシ基、メトキシジエ トキシメチルオキシ基等のオルソカーボネート基;メチ ルエーテル基、エチルエーテル基、n-プロピルエーテ ル基、イソプロピルエーテル基、n-ブチルエーテル 基、2-メチルプロピルエーテル基、1-メチルプロピ ルエーテル基、tーブチルエーテル基、シクロヘキシル エーテル基、tーブチルシクロヘキシルエーテル基等の (シクロ) アルキルエーテル基; アリルエーテル基、2 - ブテニルエーテル基、2-シクロヘキセニルエーテル 基、1-メチルー2-プロペニルエーテル基等のアルケ ニルエーテル基;ベンジルエーテル基、t-ブチルベン ジルエーテル基等のアラルキルエーテル基;ビニルエー テル基、1-プロペニルエーテル基、1-ブテニルエー テル基、1、3-ブタジエニルエーテル基、フェニルビ ニルエーテル基等のエノールエーテル基等を挙げること ができる。(へ)の方法による他の酸開裂性基の導入反 応の例としては、(ヘ-1) 各樹脂中のカルボキシル基 と2、3-ジヒドロー4H-ピランとの付加反応による エステル化反応、 (ヘー2) 各樹脂中のヒドロキシル基 と2,3-ジヒドロー4H-ピランとの付加反応による エーテル化反応、(ヘー3)各樹脂中のヒドロキシル基 とジアルキルジカーボネートとの反応によるエステル化 反応等を挙げることができる。(へ)の方法による他の 酸開裂性基の導入率は、通常、10~70モル%、好ま しくは20~60モル%である。

【0030】本発明における樹脂(A)としては、放射 線に対する透明性の観点から、炭素・炭素不飽和結合の 少ないものが好ましい。このような樹脂 (A) は、例え ば、前記(イ)の方法または前記(ホ)の開環(共)重 合する方法における適宜の段階で、あるいはこれらの方 法に続いて、水素付加、水付加、ハロゲン付加、ハロゲ ン化水素付加等の付加反応を行うことによって得ること ができ、特に水素付加反応させることにより得られる前 記樹脂(AI)が好ましい。また、前記(ロ)の方法お よび前記(ホ)のラジカル(共)重合する方法により得 られる樹脂(A)は、実質的に炭素・炭素不飽和結合を もたないものである。前記水素付加させた樹脂 (AI) における水素付加率は、好ましくは70%以上、さらに 好ましくは90%以上、特に好ましくは100%であ る。前記水素付加反応に使用される触媒としては、例え ば、通常のオレフイン性化合物の水素付加反応に用いら れているものを使用することができる。このような水素

キシカルボニル基、nーヘプチルオキシカルボニル基

18

n-オクチルオキシカルボニル基、n-デシルオキシカ ルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シク ロヘキシルオキシカルボニル基、4-t-ブチルシクロ ヘキシルオキシカルボニル基、シクロヘプチルオキシカ ルボニル基、シクロオクチルオキシカルボニル基等の (シクロ) アルコキシカルボニル基; フェノキシカルボ ニル基、4-t-ブチルフェノキシカルボニル基、1-ナフチルオキシカルボニル基等のアリーロキシカルボニ ンジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボ ニル基からなる樹脂である。樹脂(AII)において、一 般式(3)で表される繰返し単位は1種以上存在するこ とができる。

【0034】また、樹脂 (AIII)は、下記一般式 (3) で表される繰返し単位および下記一般式(4)で表され る繰返し単位を含有するランダム共重合体である。

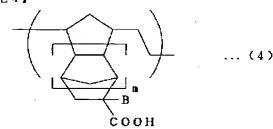
[0035]

【化3】

[0036]

【化4】

40



【0037】 [一般式(3) および一般式(4) におい て、nおよびmはそれぞれ独立に0または1であり、A およびBはそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、炭 素数1~10の1価の炭化水素基または炭素数1~10 の1価のハロゲン化炭化水素基を示し、X は酸開裂性基 を示す。〕

一般式(3) および一般式(4) において、AおよびB のハロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基ま たは炭素数 ~10の1価のハロゲン化炭化水素基、並 びにXの酸開裂性基としては、例えば、前記一般式

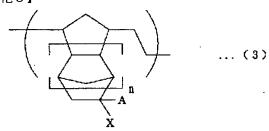
(1) および一般式(2) について例示した基と同様の ものを挙げることができる。樹脂 (AIII)としては、X の酸開裂性基が一般式(1)および一般式(2)におけ る酸開裂性基について挙げた基-(CH2), COOR¹ からなる 樹脂が好ましく、さらに好ましくはXの酸開裂性基が基 -COOR¹ からなる樹脂であり、特に好ましくはXの酸開 裂性基が、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル 基、n-プロポキシカルボニル基、イソプロポキシカル ボニル基、nーブトキシカルボニル基、2ーメチルプロ ポキシカルボニル基、1-メチルプロポキシカルボニル 基、tーブトキシカルボニル基、nーペンチルオキシカ 基、nーペンチルオキシカルボニル基、nーヘキシルオ 50 ルボニル基、nーヘキシルオキシカルボニル基、nーヘ

Pt、Ni、Rh、Ru等の貴金属を、カーボン、シリカ、アル ミナ、チタニア等の担体に担持させた固体触媒等を挙げ ることができる。これらの不均一系触媒は、単独でまた は2種以上を混合して使用することができる。また、均 一系触媒としては、例えば、ナフテン酸ニッケル/トリ エチルアルミニウム系、ニッケルアセチルアセトナート /トリエチルアルミニウム系、オクテン酸コバルト/n ーブチルリチウム系、チタノセンジクロリド/ジエチル アルミニウムモノクロリド系や、酢酸ロジウム、クロロ トリス (トリフェニルホスフィン) ロジウム等のロジウ 10 ル基;ベンジルオキシカルボニル基、4-tーブチルベ ム系等を挙げることができる。これらの均一系触媒は、 単独でまたは2種以上を混合して使用することができ る。前記水素付加触媒のうち、不均一系触媒が、反応活 性が高く、反応後の触媒除去も容易であり、得られる樹 脂(AI)の色調が優れる点で好ましい。水素付加反応 は、通常、常圧~300気圧、好ましくは3~200気 圧の水素ガス雰囲気下において、通常、0~200℃、 好ましくは20~180℃で実施することができる。

【0031】本発明における樹脂(AI)としては、特 に下記樹脂 (AII)、樹脂 (AIII)および樹脂 (AIV) が好ましい。樹脂 (AII) は、下記一般式 (3) で表さ れる繰返し単位を含有する樹脂である。

[0032]

【化3】



【0033】 [一般式 (3) において、nは0または1 であり、Aは水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~10 の1価の炭化水素基または炭素数1~10の1価のハロ ゲン化炭化水素基を示し、Xは酸開裂性基を示す。〕 一般式(3)において、Aのハロゲン原子、炭素数1~ 10の1価の炭化水素基または炭素数1~10の1価の ハロゲン化炭化水素基およびXの酸開裂性基としては、 例えば、前記一般式(1)および一般式(2)について 例示した基と同様のものを挙げることができる。樹脂 (AII) としては、Xの酸開裂性基が一般式(1)およ び一般式(2)における酸開裂性基について挙げた基-(CH₂), COOR¹ からなる樹脂が好ましく、さらに好まし くはXの酸開裂性基が基-COOR1からなる樹脂であり、 特に好ましくはXの酸開裂性基が、メトキシカルボニル 基、エトキシカルボニル基、n-プロポキシカルボニル 基、イソプロポキシカルボニル基、n-プトキシカルボ ニル基、2-メチルプロポキシカルボニル基、1-メチ ルプロポキシカルボニル基、t-ブトキシカルボニル

プチルオキシカルボニル基、nーオクチルオキシカルボニル基、nーデシルオキシカルボニル基、シクロペンチルオキシカルボニル基、シクロペキシルオキシカルボニル基、シクロペプチルオキシカルボニル基、シクロペプチルオキシカルボニル基、シクロペプチルオキシカルボニル基、シクロオクチルオキシカルボニル基等の(シクロ)アルコキシカルボニル基;フェノキシカルボニル基、4ーtーブチルフェノキシカルボニル基;ベンジルオキシカルボニル基等のアリーロキシカルボニル基;ベンジルオキシカルボニル基等のアラルキルオキシカルボニル基からなる樹脂である。樹脂(AIII)における一般式(3)で表される繰返し単位と一般式(4)で表される繰返し単位とのモル比は、通常、20/80~95/5、好ましくは30/70~90/10である。樹脂(AIII)において、一般式

(3)で表される繰返し単位および一般式(4)で表される繰返し単位は、それぞれ1種以上存在することができる。

【0038】また、樹脂(AIV)は、下記一般式(5)で表される繰返し単位および下記一般式(6)で表され 20る繰返し単位を含有するランダム共重合体である。

[0039]

【化5】

【0040】 【化6】

【0041】 [一般式(5) および一般式(6) において、AおよびBはそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基または炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基を示し、XおよびYはそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基または酸開裂性基を示し、かつXおよびYのうち少なくとも一つは酸開裂性基である。] 一般式(5) および一般式(6) において、A、B、XおよびYのハロゲン原子、炭素数1~10の1価の炭化水素基または炭素数1~10の1価の内でが上炭化水素基または炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基、並びにXおよびYの酸開裂性基としては、例えば、前記一般式(1) および一般式(2) について例示

した基と同様のものを挙げることができる。 樹脂 (AI V) としては、XおよびYの酸開裂性基が一般式 (1) および一般式(2)における酸開裂性基について挙げた 基-(CH₂)_i COOR¹ からなる樹脂が好ましく、さらに好ま しくはXおよびYの酸開裂性基が基 -COOR¹ からなる樹 脂であり、特に好ましくはXおよびYの酸開裂性基が、 メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、nープ ロポキシカルボニル基、イソプロポキシカルボニル基、 n-ブトキシカルボニル基、2-メチルプロポキシカル ボニル基、1-メチルプロポキシカルボニル基、t-ブ トキシカルボニル基、n-ペンチルオキシカルボニル 基、n-ヘキシルオキシカルボニル基、n-ヘプチルオ キシカルボニル基、n-オクチルオキシカルボニル基、 n-デシルオキシカルボニル基、シクロペンチルオキシ カルボニル基、シクロヘキシルオキシカルボニル基、4 tーブチルシクロヘキシルオキシカルボニル基、シク ロヘプチルオキシカルボニル基、シクロオクチルオキシ カルボニル基等の(シクロ)アルコキシカルボニル基; フェノキシカルボニル基、4-t-ブチルフェノキシカ ルボニル基、1-ナフチルオキシカルボニル基等のアリ ーロキシカルボニル基:ベンジルオキシカルボニル基、 4-t-ブチルベンジルオキシカルボニル基等のアラル キルオキシカルボニル基からなる樹脂である。樹脂(A IV) における一般式(5)で表される繰返し単位と一般 式(6)で表される繰返し単位とのモル比は、通常、5 $/95\sim95/5$ 、好ましくは $10/90\sim90/10$ である。樹脂(AIV)において、一般式(5)で表され る繰返し単位および一般式(6)で表される繰返し単位 は、それぞれ1種以上存在することができる。

【0042】本発明における樹脂(A)のゲルパーミエ ーションクロマトグラフィー (GPC) によるポリスチ レン換算重量平均分子量(以下、「Mw」という。) は、通常、5,000~300,000、好ましくは 5,000~200,000、さらに好ましくは10、 000~100、000である。この場合、樹脂 (A) のMwが5,000未満では、レジストとしての耐熱性 が低下する傾向があり、また300,000を超える と、レジストとしての現像性が低下する傾向がある。ま た、本発明における樹脂(A)のガラス転移点は、好ま しくは80~180°C、さらに好ましくは90~170 ℃の範囲にある。この場合、樹脂(A)のガラス転移点 が80~180℃の範囲にあることにより、レジストと しての耐熱性、感度等が特に優れた感放射線性樹脂組成 物を得ることができる。本発明において、樹脂 (A) は、単独でまたは2種以上を混合して使用することがで きる。

およびYのハロゲン原子、炭素数 $1\sim10$ の1価の炭化 【0043】さらに、本発明における樹脂(A)、好ま水素基または炭素数 $1\sim10$ の1価のハロゲン化炭化水 しくは樹脂(AI)、特に好ましくは樹脂(AII)、樹 脂(AIII)および樹脂(AIV)は、不純物が少ないほどば、前記一般式(1)および一般式(2)について例示 50 好ましい。この不純物は、主に各樹脂を製造する際に使

用される触媒に由来するものであり、レジストとしての 観点から特に考慮すべき不純物の例としては、ふっ素、 塩素、臭素等のハロゲンや、デミングの周期律表IV族、 V族、VI族、 VII族およびVIII族の金属等を挙げること ができる。この場合、樹脂中の残留ハロゲンの含有量を 3 p p m 以下、特に 2 p p m 以下とし、また残留金属の 含有量を300ppb以下、特に100ppb以下とす ることが好ましく、さらに残留ハロゲンの含有量を3p pm以下、特に2ppm以下とし、かつ残留金属の含有 量を300ppb以下、特に100ppb以下とするこ 10 とが好ましい。これらの不純物の含有量を前記値以下と することにより、レジストとしての感度、解像度、プロ セス安定性等に加え、本発明の感放射線性樹脂組成物を 用いて半導体を製造する際の歩留り等がさらに改善され る。樹脂中の不純物を低減する方法としては、残留ハロ ゲンの場合、(a) 樹脂溶液の純水による洗浄あるいは 液々抽出、(b)樹脂溶液の純水による洗浄あるいは液 々抽出と限外ろ過、遠心分離等の物理的精製法との組み 合わせや、(c)これらの方法で純水の代わりにアルカ リ性水溶液あるいは酸性水溶液を使用する方法等を挙げ 20 ることができる。また、残留金属の場合は、前記(a) ~ (c) の方法と同様の方法に加えて、(d) 樹脂を、 酸化、還元、配位子交換、対イオン交換等により処理し て、樹脂中の残留金属の溶剤あるいは水への溶解性を著 しく高めてから、前記(a)~(c)の方法で処理する 方法等を挙げることができる。これらの不純物を低減す る処理は、樹脂を製造する重合後の適宜の段階で実施す

【0044】(B)酸発生剤

ることができる。

本発明において使用される(B)放射線の照射(以下、 「露光」という。) により酸を発生する感放射線性酸発 生剤(以下、「酸発生剤(B)」という。)は、露光に より発生した酸の作用によって、樹脂(A)および/ま たは後述する酸開裂性添加剤中に存在する酸開裂性基を 開裂させ、その結果レジスト被膜の露光部がアルカリ現 像液に易溶性となり、ポジ型のレジストパターンを形成 する作用を有するものである。このような酸発生剤

(B) としては、①オニウム塩、②ハロゲン含有化合 物、③ジアゾケトン化合物、④スルホン化合物、⑤スル ホン酸化合物等を挙げることができる。これらの酸発生 40 剤(B)の例としては、下記のものを挙げることができ る。

①オニウム塩

オニウム塩としては、例えば、ヨードニウム塩、スルホ ニウム塩、ホスホニウム塩、ジアゾニウム塩、ピリジニ ウム塩等を挙げることができる。好ましいオニウム塩の 具体例としては、ジフェニルヨードニウムトリフレー ト、ジフェニルヨードニウムピレンスルホネート、ジフ エニルヨードニウムドデシルベンゼンスルホネート、ビ 22

ト、ビス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムドデ シルベンゼンスルホネート、ビス(4-tーブチルフェ ニル) ヨードニウムナフタレンスルホネート、ビス (4 - t - ブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフルオロア ンチモネート、トリフェニルスルホニウムトリフレー ト、トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモ ネート、トリフェニルスルホニウムナフタレンスルホネ ート、(ヒドロキシフェニル)ベンゼンメチルスルホニ ウムトルエンスルホネート、1-(ナフチルアセトメチ ル) チオラニウムトリフレート、シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフレー ト、ジシクロヘキシル (2-オキソシクロヘキシル) ス ルホニウムトリフレート、ジメチル (2-オキソシクロ ヘキシル)スルホニウムトリフレート、ジメチル (4-ヒドロキシナフチル) スルホニウムトリフレート、ジメ チル (4-ヒドロキシナフチル) スルホニウムトシレー ト、ジメチル (4-ヒドロキシナフチル) スルホニウム ドデシルベンゼンスルホネート、ジメチル (4ーヒドロ キシナフチル)スルホニウムナフタレンスルホネート、 ジフェニルヨードニウムヘキサフルオロアンチモネー ト、トリフェニルスルホニウムカンファースルホネー ト、(4-ヒドロキシフェニル)ベンジルメチルスルホ ニウムトルエンスルホネート等を挙げることができる。

②ハロゲン含有化合物

ハロゲン含有化合物としては、例えば、ハロアルキル基 含有炭化水素化合物、ハロアルキル基含有複素環式化合 物等を挙げることができる。好ましいハロゲン含有化合 物の具体例としては、フェニルービス(トリクロロメチ ル) - s - トリアジン、メトキシフェニルービス (トリ クロロメチル) - s - トリアジン、ナフチルービス (ト リクロロメチル) - s - トリアジン等の (トリクロロメ チル) - s - トリアジン誘導体や、1, 1 - ビス (4 -クロロフェニル) -2, 2, 2-トリクロロエタン等を 挙げることができる。

③ジアゾケトン化合物

ジアゾケトン化合物としては、例えば、1,3-ジケト - 2 - ジアゾ化合物、ジアゾベンゾキノン化合物、ジア ゾナフトキノン化合物等を挙げることができる。好まし いジアゾケトンの具体例としては、1,2-ナフトキノ ンジアジドー4ースルホニルクロリド、1,2ーナフト キノンジアジドー5ースルホニルクロリド、2,3, 4, 4'ーテトラヒドロベンゾフェノンの1, 2ーナフ トキノンジアジドー4ースルホン酸エステルまたは1, 2-ナフトキノンジアジド-5-スルホン酸エステル、 1, 1, 1ートリス (4ーヒドロキシフェニル) エタン の1、2-ナフトキノンジアジド-4-スルホン酸エス テルまたは1,2ーナフトキノンジアジドー5ースルホ ン酸エステル等を挙げることができる。

④スルホン化合物

ス (4-t-ブチルフェニル) ヨードニウムトリフレー 50 スルホン化合物としては、例えば、β-ケトスルホン、

β-スルホニルスルホンや、これらの化合物のα-ジア ゾ化合物等を挙げることができる。好ましいスルホン化 合物の具体例としては、4-トリスフェナシルスルホ ン、メシチルフェナシルスルホン、ビス(フェニルスル ホニル)メタン等を挙げることができる。

⑤スルホン酸化合物

スルホン酸化合物としては、例えば、アルキルスルホン 酸エステル、アルキルスルホン酸イミド、ハロアルキル スルホン酸エステル、アリールスルホン酸エステル、イ ミノスルホネート等を挙げることができる。好ましいス 10 ルホン酸化合物の具体例としては、ベンゾイントシレー ト、ピロガロールのトリストリフレート、ニトロベンジ ルー9,10-ジエトキシアントラセン-2-スルホネ ート、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプトー5ーエンー2, 3ージカルボジイミ ド、N-ヒドロキシスクシイミドトリフレート、1,8 ナフタレンジカルボン酸イミドトリフレート等を挙げ ることができる。これらの酸発生剤(B)のうち、特 に、ジフェニルヨードニウムトリフレート、ビス (4tープチルフェニル) ヨードニウムトリフレート、トリ フェニルスルホニウムトリフレート、シクロヘキシルメ チル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフ レート、ジシクロヘキシル (2-オキソシクロヘキシ ル)スルホニウムトリフレート、ジメチル(2-オキソ シクロヘキシル) スルホニウムトリフレート、1-(ナ フチルアセトメチル)チオラニウムトリフレート、4-ヒドロキシナフチルジメチルスルホニウムトリフレー ト、ジメチル (4-ヒドロキシナフチル) スルホニウム トリフレート、トリフルオロメタンスルホニルビシクロ イミド、Nーヒドロキシスクシイミドトリフレート、 1,8-ナフタレンジカルボン酸イミドトリフレート等 が好ましい。本発明において、酸発生剤(B)は、単独 でまたは2種以上を混合して使用することができる。酸 発生剤(B)の使用量は、レジストとしての感度および 現像性を確保する観点から、樹脂(A)100重量部に 対して、通常、0.1~10重量部、好ましくは0.5 ~7重量部である。この場合、酸発生剤(B)の使用量 が 0. 1 重量部未満では、感度および現像性が低下し、 また10重量部を超えると、放射線に対する透明性が低 40 下して、矩形のレジストパターンを得られ難くなる傾向 がある。

【0045】<u>酸開裂性添加剤</u>

樹脂(A)が、樹脂(AI)、樹脂(AII)、樹脂(A III)および樹脂(AIV)のように、酸開裂性基を有する場合、酸の作用により開裂して、アルカリ現像液に対する親和性が向上する基を有する化合物(以下、「酸開裂性添加剤」という。)を配合することにより、化学増幅型ポジ型レジストとしてのコントラストをさらに向上させることができる。また、樹脂(A)が酸開裂性基をも50

たない場合、本発明の感放射線性樹脂組成物を化学増幅型ポジ型レジストとして使用するためには、酸開裂性添加剤を配合することが必要である。このような酸開裂性添加剤としては、例えば、tーブチル基で保護された水酸基および/またはカルボキシル基、テトラヒドロピラニル基で保護された水酸基および/またはカルボキシル基、3ーオキソシクロヘキシル基で保護されたカルボキシル基、イソボルニル基で保護されたカルボキシル基、イソボルニル基で保護された水酸基等の酸開裂性基を少なくとも1種有する高分子化合物あるいは低分子化合物を挙げることができる。

24

【0046】酸開裂性添加剤のうち、高分子化合物とし ては、例えば、tーブチル(メタ)アクリレート単位、 テトラヒドロピラニル (メタ) アクリレート単位、3-オキソシクロヘキシル(メタ)アクリレート単位および イソボルニル(メタ)アクリレートの群から選ばれる繰 返し単位を少なくとも1種含有する(共) 重合体を挙げ ることができる。このような高分子化合物の具体例とし ては、tーブチル(メタ)アクリレートの単独重合体、 tーブチル(メタ)アクリレート/メチル(メタ)アク リレート共重合体、tーブチル(メタ)アクリレート/ (メタ) アクリル酸共重合体、t-ブチル (メタ) アク リレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アク リル酸共重合体、t-ブチル(メタ)アクリレート/メ チル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/アダ マンチル(メタ)アクリレート共重合体、tーブチル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/アダマンチルメチル (メタ) アク リレート共重合体、tーブチル(メタ)アクリレート/ メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/テ トラシクロデカニル (メタ) アクリレート共重合体、 t ーブチル(メタ)アクリレート/メチル(メタ)アクリ レート/ (メタ) アクリル酸/テトラヒドロピラニル (メタ) アクリレート共重合体、t-ブチル(メタ) ア クリレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) ア クリル酸/3-オキソシクロヘキシル (メタ) アクリレ ート共重合体、tーブチル(メタ)アクリレート/メチ ル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/イソボ ルニル (メタ) アクリレート共重合体;テトラヒドロピ ラニル (メタ) アクリレートの単独重合体、テトラヒド ロピラニル(メタ)アクリレート/メチル(メタ)アク リレート共重合体、テトラヒドロピラニル (メタ) アク リレート/(メタ)アクリル酸共重合体、テトラヒドロ ピラニル(メタ)アクリレート/メチル(メタ)アクリ レート/ (メタ) アクリル酸共重合体、テトラヒドロピ ラニル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレ ート/(メタ)アクリル酸/アダマンチル(メタ)アク リレート共重合体、テトラヒドロピラニル (メタ) アク リレート/メチル(メタ)アクリレート/(メタ)アク リル酸/アダマンチルメチル (メタ) アクリレート共重

26

合体、テトラヒドロピラニル (メタ) アクリレート/メ チル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/テト ラシクロデカニル (メタ) アクリレート共重合体、テト ラヒドロピラニル (メタ) アクリレート/メチル (メ タ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/ t ーブチル (メタ) アクリレート共重合体、テトラヒドロピラニル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/3-オキソシクロヘキシル (メ タ) アクリレート共重合体、テトラヒドロピラニル (メ タ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メ 10 タ) アクリル酸/イソボルニル (メタ) アクリレート共 重合体;3-オキソシクロヘキシル(メタ)アクリレー トの単独重合体、3-オキソシクロヘキシル (メタ) ア クリレート/メチル (メタ) アクリレート共重合体、3 -オキソシクロヘキシル (メタ) アクリレート/ (メ タ) アクリル酸共重合体、3-オキソシクロヘキシル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸共重合体、3-オキソシクロヘキシ ル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレート / (メタ) アクリル酸/アダマンチル (メタ) アクリレ 20 ート共重合体、3-オキソシクロヘキシル(メタ)アク リレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アク リル酸/アダマンチルメチル (メタ) アクリレート共重 合体、3-オキソシクロヘキシル (メタ) アクリレート /メチル(メタ)アクリレート/(メタ)アクリル酸/ テトラシクロデカニル (メタ) アクリレート共重合体、 3-オキソシクロヘキシル (メタ) アクリレート/メチ ル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/ t ーブ チル (メタ) アクリレート共重合体、3-オキソシクロ ヘキシル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリ レート/ (メタ) アクリル酸/テトラヒドロピラニル (メタ) アクリレート共重合体、3-オキソシクロヘキ シル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレー ト/ (メタ) アクリル酸/イソボルニル (メタ) アクリ レート共重合体、イソボルニル(メタ)アクリレートの 単独重合体、イソボルニル (メタ) アクリレート/メチ ル (メタ) アクリレート共重合体、イソボルニル (メ タ)アクリレート/(メタ)アクリル酸共重合体、イソ ボルニル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリ レート/ (メタ) アクリル酸共重合体、イソボルニル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/アダマンチル (メタ) アクリレー ト共重合体、イソボルニル (メタ) アクリレート/メチ ル (メタ) アクリレート/ (メタ) アクリル酸/アダマ ンチルメチル (メタ) アクリレート共重合体、イソボル ニル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アクリレー ト/ (メタ) アクリル酸/テトラシクロデカニル (メ タ)アクリレート共重合体、イソボルニル(メタ)アク リレート/メチル (メタ) アクリレート/ (メタ) アク リル酸/tーブチル(メタ)アクリレート共重合体、イ 50 ルアミン、トリnーブチルアミン、トリnーヘキシルア

ソボルニル (メタ) アクリレート/メチル (メタ) アク リレート/(メタ)アクリル酸/テトラヒドロピラニル (メタ) アクリレート共重合体、イソボルニル (メタ) アクリレート/メチル(メタ)アクリレート/(メタ) アクリル酸/3-オキソシクロヘキシル(メタ)アクリ レート共重合体等を挙げることができる。これらの高分 子化合物は、単独でまたは2種以上を混合して使用する ことができる。

【0047】また、酸開裂性添加剤のうち、低分子化合 物の具体例としては、アダマンタンカルボン酸 tーブチ ル、アダマンタンカルボン酸テトラヒドロピラニル、ア ダマンタンカルボン酸3-オキソシクロヘキシル、アダ マンタン酢酸 t ーブチル、アダマンタン酢酸テトラヒド ロピラニル、アダマンタン酢酸3-オキソシクロヘキシ ル;1-ナフチル酢酸 t ーブチル、1-ナフチル酢酸テ トラヒドロピラニル、1ーナフチル酢酸3ーオキソシク ロヘキシル、2-ナフチル酢酸 t -ブチル、2-ナフチ ル酢酸テトラヒドロピラニル、2ーナフチル酢酸3ーオ キソシクロヘキシル、1-ナフトイックアシド t -ブチ ル、1ーナフトイックアシドテトラヒドロピラニル、1 ーナフトイックアシド3ーオキソシクロヘキシル、2ー ナフトイックアシドtーブチル、2-ナフトイックアシ ドテトラヒドロピラニル、2-ナフトイックアシド3-オキソシクロヘキシル;コリック酸 t ーブチル、コリッ ク酸テトラヒドロピラニル、コリック酸3ーオキソシク ロヘキシル; 1-t-ブトキシカルボニルオキシナフタ レン、2-t-ブトキシカルボニルオキシナフタレン、 1,5-ビス(t-ブトキシカルボニルオキシ)ナフタ レン、1-カルボー t ーブトキシメトキシナフタレン。 2-カルボーt-ブトキシメトキシナフタレン、1、5ビス(カルボーtーブトキシメトキシ)ナフタレン等 を挙げることができる。これらの低分子化合物は、単独 でまたは2種以上を混合して使用することができる。ま た、本発明においては、酸開裂性添加剤として、高分子 化合物と低分子化合物とを併用してもよい。酸開裂性添 加剤の配合量は、樹脂(A)100重量部に対して、通 常、200重量部以下、好ましくは5~150重量部で ある。この場合、酸開裂性添加剤の配合量が200重量 部を超えると、基板への接着性が低下する傾向がある。 【0048】また、本発明のポジ型感放射線性樹脂組成 物は、酸発生剤(B)から発生する酸に対してルイス塩 基として作用する化合物(以下、「ルイス塩基添加剤」 という。)を配合することにより、レジストパターンの 側壁の垂直性をより効果的に改善することができる。こ のようなルイス塩基添加剤としては、例えば、含窒素塩 基性化合物やその塩類、カルボン酸類、アルコール類等 を挙げることができるが、含窒素塩基性化合物が好まし い。前記含窒素塩基性化合物の具体例としては、トリエ チルアミン、トリn-プロピルアミン、トリイソプロピ

ミン、トリエタノールアミン、トリフェニルアミン、ア ニリン、N, N-ジメチルアニリン、2-メチルアニリ ン、3-メチルアニリン、4-メチルアニリン、4-ニ トロアニリン、1ーナフチルアミン、2ーナフチルアミ ン、ジフェニルアミン、エチレンジアミン、テトラメチ レンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ピロリジン、 ピペリジン等のアミン化合物;イミダゾール、4ーメチ ルイミダゾール、4ーメチルー2ーフェニルイミダゾー ル、チアベンダゾール等のイミダゾール化合物;ピリジ ン、2-メチルピリジン、4-エチルピリジン、2-ヒ 10 ドロキシピリジン、4ーヒドロキシピリジン、2ーフェ ニルピリジン、4ーフェニルピリジン、ニコチン酸、ニ コチン酸アミド、キノリン、アクリジン等のピリジン化 合物; プリン、1,3,5-トリアジン、トリフェニル ル、1,2,4-トリアゾール、ウラゾール等の他の含 **窒素複素環化合物等を挙げることができる。これらの含** 窒素塩基性化合物は、単独でまたは2種以上を混合して 使用することができる。ルイス塩基添加剤の配合量は、 酸発生剤(B)1モルに対して、通常、1モル以下、好 ましくは0.05~1モルである。この場合、ルイス塩 基添加剤の配合量が1モルを超えると、レジストとして の感度が低下する傾向がある。

【0049】さらに、本発明の感放射線性樹脂組成物に は、必要に応じて、他の各種添加剤を配合することがで きる。このような添加剤としては、例えば、塗布性、現 像性等を改良する作用を示す界面活性剤を挙げることが できる。前記界面活性剤としては、例えば、ポリオキシ エチレンラウリルエーテル、ポリオキシエチレンステア リルエーテル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、 ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオ キシエチレンノニルフェニルエーテル、ポリエチレング リコールジラウレート、ポリエチレングリコールジステ アレート等のノニオン系界面活性剤のほか、以下商品名 で、KP341(信越化学工業製)、ポリフローNo. 75, 同No. 95 (共栄社油脂化学工業製)、エフト ップEF301、同EF303、同EF352 (トーケ ムプロダクツ製)、メガファックスF171、同F17 3 (大日本インキ化学工業製)、フロラードFC43 0, 同FC431 (住友スリーエム製)、アサヒガード 40 AG710, サーフロンS-382, 同SC-101, 同SC-102, 同SC-103, 同SC-104, 同 SC-105, 同SC-106 (旭硝子製) 等を挙げる ことができる。これらの界面活性剤は、単独でまたは2 種以上を混合して使用することができる。界面活性剤の 配合量は、樹脂(A)、酸発生剤(B)および酸開裂性 添加剤の合計100重量部に対して、通常、2重量部以 下である。また、前記以外の添加剤としては、ハレーシ ョン防止剤、接着助剤、保存安定化剤、消泡剤等を挙げ

ることができる。

【0050】本発明の感放射線性樹脂組成物は、樹脂(A)および酸発生剤(B)を必須の構成成分とし、必要に応じて酸開裂性添加剤、ルイス塩基添加剤あるいは他の添加剤を含有するが、かかる感放射線性樹脂組成物は、特に、化学増幅型ポジ型レジストとして有用である。前記化学増幅型ポジ型レジストにおいては、露光により酸発生剤(B)から発生した酸の作用によって、樹脂(A)および/または酸開裂性添加剤中の酸開裂性基が、例えば、(ト)アルコキシカルボニル基が開裂してカルボキシル基に変換される反応、(チ)アルキルカルボニルオキシ基が開裂して水酸基に変換される反応、

(リ)シアノ基が開裂してカルボキシル基に変換される 反応、(ヌ)酸無水物基が開裂してカルボキシル基に変換される反応等を生起し、その結果レジストの露光部の アルカリ現像液に対する溶解性が高くなり、該露光部が アルカリ現像液によって溶解、除去され、ポジ型のレジ ストパターンが得られる。

【0051】組成物溶液の調製

本発明の感放射線性樹脂組成物は、その使用に際して、 全固形分の濃度が、例えば5~50重量%となるよう に、溶剤に溶解したのち、通常、例えば孔径 0.2 μm 程度のフィルターでろ過することによって、組成物溶液 として調製される。前記組成物溶液の調製に使用される 溶剤としては、例えば、n-プロピルアルコール、イソ プロピルアルコール、n-ブチルアルコール、t-ブチ ルアルコール、シクロヘキサノール、エチレングリコー ルモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチル エーテル、エチレングリコールモノーnープロピルエー テル、エチレングリコールモノーn-ブチルエーテル、 ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレング リコールジエチルエーテル、ジエチレングリコールジー n-プロピルエーテル、ジエチレングリコールジーn-ブチルエーテル、エチレングリコールモノメチルエーテ ルアセテート、エチレングリコールモノエチルエーテル アセテート、エチレングリコールモノーnープロピルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノエチルエ ーテルアセテート、プロピレングリコールモノー n ープ ロピルエーテルアセテート、トルエン、キシレン、メチ ルエチルケトン、メチルnープロピルケトン、イソプロ ピルケトン、メチルn-ブチルケトン、メチルイソブチ ルケトン、2-ヘプタノン、3-ヘプタノン、4-ヘプ タノン、シクロペンタノン、シクロヘキサノン、2-ヒ ドロキシプロピオン酸メチル、2-ヒドロキシプロピオ ン酸エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロピオン酸 エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸エチル、 2-ヒドロキシー3-メチル酪酸メチル、3-メトキシ ブチルアセテート、3-メチル-3-メトキシブチルア セテート、3-メチル-3-メトキシブチルプロピオネ 50 ート、3-メチル-3-メトキシブチルブチレート、酢

酸エチル、酢酸nープロピル、酢酸nーブチル、アセト 酢酸メチル、アセト酢酸エチル、3-メトキシプロピオ ン酸メチル、3-エトキシプロピオン酸エチル、ピルビ ン酸メチル、ピルビン酸エチル、N-メチルピロリド ン、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチル アセトアミド、ベンジルエチルエーテル、ジヘキシルエ ーテル、ジエチレングリコールモノメチルエーテル、ジ エチレングリコールモノエチルエーテル、アセトニルア セトン、イソホロン、カプロン酸、カプリル酸、1-オ クタノール、1ーノナノール、ベンジルアルコール、酢 10 酸ベンジル、安息香酸エチル、しゅう酸ジエチル、マレ イン酸ジエチル、γーブチロラクトン、炭酸エチレン、 炭酸プロピレン等を挙げることができる。これらの溶剤 は、単独でまたは2種以上を混合して使用される。

【0052】レジストパターンの形成方法 本発明の感放射線性樹脂組成物からレジストパターンを 形成する際には、前記のようにして調製された組成物溶 液を、回転塗布、流延塗布、ロール塗布等の適宜の塗布 手段によって、例えば、シリコンウエハー、アルミニウ ムで被覆されたウエハー等の基板上に塗布することによ 20 り、レジスト被膜を形成し、場合により予めプレベーク を行ったのち、所定のレジストパターンを形成するよう に該レジスト被膜に露光する。その際に使用される放射 線としては、KrFエキシマレーザー(波長248n m) あるいはArFエキシマレーザー(波長193n m)等の遠紫外線、シンクロトロン放射線等のX線、電 子線等の荷電粒子線の如き各種放射線を使用することが できるが、好ましくはKrFエキシマレーザーまたはA rFエキシマレーザー、特に好ましくはArFエキシマ レーザーが使用される。本発明においては、露光後に加 30 熱処理(以下、「露光後ベーク」という。)を行うこと が好ましい。この露光後ベークにより、前記(ト)~ (ヌ) 等の反応が円滑に進行する。露光後ベークの加熱 条件は、組成物の配合組成によって変わるが、通常、3 0~200℃、好ましくは50~170℃である。本発 明においては、感放射線性樹脂組成物の潜在能力を最大 限に引き出すため、例えば特公平6-12452号公報 等に開示されているように、使用される基板上に有機系 あるいは無機系の反射防止膜を形成しておくこともで き、また環境雰囲気中に含まれる塩基性不純物等の影響 40 を防止するため、例えば特開平5-188598号公報 等に開示されているように、レジスト被膜上に保護膜を 設けることもでき、あるいはこれらの技術を併用するこ ともできる。次いで、露光されたレジスト被膜を現像す ることにより、所定のレジストパターンを形成する。本 発明の感放射線性樹脂組成物を化学増幅型ポジ型レジス トとして使用する際の現像液としては、例えば、水酸化 ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、けい酸 ナトリウム、メタけい酸ナトリウム、アンモニア水、エ チルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミン、ジ 50 における吸光度から、放射線透過率を算出して、遠紫外

-n-プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエ チルアミン、ジメチルエチルアミン、トリエタノールア ミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、ピロー ル、ピペリジン、コリン、1,8-ジアザビシクロー [5.4.0] - 7 - ウンデセン、1,5 - ジアザビシ クロー [4.3.0] -5-ノネン等のアルカリ性化合 物の少なくとも1種を溶解したアルカリ性水溶液が好ま しい。該アルカリ性水溶液の濃度は、通常、10重量% 以下である。この場合、アルカリ性水溶液の濃度が10 重量%を超えると、未露光部も現像液に溶解し、好まし くない。また、前記アルカリ性水溶液からなる現像液に は、例えば有機溶剤を添加することもできる。前記有機 溶剤の具体例としては、アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソブチルケトン、シクロペンタノン、シク ロヘキサノン、3ーメチルー2ーシクロペンタノン、 2,6-ジメチルシクロヘキサノン等のケトン類;メチ ルアルコール、エチルアルコール、nープロピルアルコ ール、イソプロピルアルコール、n-ブチルアルコー ル、tーブチルアルコール、シクロペンタノール、シク ロヘキサノール、1、4-ヘキサンジオール、1、4-ヘキサンジメチロール等のアルコール類;テトラヒドロ フラン、ジオキサン等のエーテル類;酢酸エチル、酢酸 ブチル、酢酸イソアミル等のエステル類;トルエン、キ シレン等の芳香族炭化水素類や、フェノール、アセトニ ルアセトン、ジメチルホルムアミド等を挙げることがで きる。これらの有機溶剤は、単独でまたは2種以上を混 合して使用することができる。有機溶剤の使用量は、ア ルカリ性水溶液に対して、100容量%以下が好まし い。この場合、有機溶剤の使用量が100容量%を超え ると、現像性が低下し、露光部の現像残りが著しくな り、好ましくない。また、アルカリ性水溶液からなる現 像液には、界面活性剤等を適量添加することもできる。 なお、アルカリ性水溶液からなる現像液で現像したのち は、一般に、水で洗浄して乾燥する。

[0053]

【発明の実施の形態】以下、実施例を挙げて、本発明の 実施の形態をさらに具体的に説明する。但し、本発明 は、これらの実施例に何ら制約されるものではない。実 施例(但し、実施例4を除く。)および比較例における 各測定・評価は、下記の要領で行った。

Mw:東ソー(株) 製GPCカラム(G2000HXL2 本、G3000HXL 1本、G4000HXL 1本) を用 い、流量1.0ml/分、溶出溶媒テトラヒドロフラ ン、カラム温度40℃の分析条件で、単分散ポリスチレ ンを標準とするゲルパーミエーションクロマトグラフィ 一(GPC)により測定した。

放射線透過率:各樹脂溶液または組成物溶液を石英ガラ ス上にスピンコートした乾燥膜厚1. 0μmのレジスト 被膜について、波長248nmあるいは波長193nm 線領域における透明性の尺度とした。

エッチング速度:各樹脂塗膜またはレジスト被膜に対して、ドライエッチング装置(日電アネルバ社製、DEM 451)を用い、エッチングガスをCF4とし、ガス流量30sccm、圧力5Pa、出力100Wの条件でドライエッチングを行い、エッチング速度を測定した。エッチング速度の小さいほど、ドライエッチング耐性に優れることを意味する。

基板接着性:現像後、洗浄した 0.30μ mライン・アンド・スペースパターン(1L1S)のポジ型レジスト 10パターンについて、走査型電子顕微鏡でパターンの接着具合を観察し、パターンの剥がれや浮き等の不具合が認められない場合を"良好"とし、これらの不具合が認められる場合を"不良"とした。

感度:各組成物溶液をシリコーンウエハー上にスピンコートしたのち、110 ℃に保持したホットプレート上で 1 分間プレベークを行って、膜厚0. 6μ mのレジスト 被膜を形成した。このレジスト被膜に、(株)ニコン製ArFエキシマレーザー露光装置(レンズ開口数0. 50、露光波長193nm)により、マスクパターンを介 20 して露光した。次いで、90 ℃に保持したホットプレート上で1 分間露光後ベークを行ったのち、2. 38 重量 %テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液により、25 ℃で1 分間現像し、水洗し、乾燥して、ポジ型レジストパターンを形成した。その際、0. 35μ mライン・アンド・スペースパターン(1 L 1 S)を1 対 1 の線幅に形成する露光量を最適露光量とし、この最適露 光量を感度とした。

解像度:最適露光量で露光したときに解像される最小の ポジ型レジストパターンの寸法を解像度とした。

現像性:感度の評価と同様にして形成したポジ型レジストパターンについて、現像後のスカムや現像残りの程度を、走査型電子顕微鏡にて観察した。

【0054】合成例1

(1) 8-メチルー8-メトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}] -3-ドデセンの合成

温度 180 \mathbb{C} 、圧力 3.5 \mathbb{k} \mathbb{g}/\mathbb{c} \mathbb{m}^2 \mathbb{E} \mathbb

持したフラッシュ蒸留塔に連続的供給し、未反応原料の 一部を分離した。前記フラッシュ蒸留塔からの留出物 を、充填材(商品名スルザーパッキンBX、住友重機

で、元頃村(間面名ベルリーバッキンBA、住及里機 (株)製)の充填高さが濃縮部で119cm、回収部で 102cmである塔径3インチの蒸留塔に連続的に供給 して、塔頂圧力5torr、還流比1で蒸留し、前記フ ラッシュ蒸留塔で分離できなかった未反応原料を、塔頂 から回収し、塔底からは、下記式(9)で表される8-メチルー8-メトキシカルボニルテトラシクロ[4.

4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー3-エンを67重量 %含有する溶液を回収した。

[0055]

【化10】

【0056】(2)重合

攪拌機、還流冷却器および三方コックを備えたセパラブルフラスコ内を窒素置換し、窒素気流下で、8-メチル-8-メトキシカルボニルテトラシクロ[$4.4.0.1^{2.6}$. $1^{7.10}$]ドデカー3-エン100重量部、1- へキセン(分子量調節剤)33重量部、トルエン200 重量部を仕込み、80 $\mathbb C$ に加熱した。次いで、メタセシス触媒としてトリエチルアルミニウムのトルエン溶液(濃度1.5 モル/リットル)0.17 重量部とWCl₆のトルエン溶液(濃度0.05 モル/リットル)1.0 重量部を加え、80 $\mathbb C$ で3時間攪拌して重合して、下記式で表される繰返し単位からなる樹脂(収率67 重量%)の溶液を得た。この樹脂を、樹脂(A-1)とする。

[0057]

30

【化11】

【0058】(3)水素付加

た。また、重合禁止剤としてp-メトキシフェノールを オートクレーブに、樹脂(A-1)400重量部と、水素 メチルメタクリレートに溶解して、反応原料の合計供給 付加触媒としてクロロヒドロカルボニルトリフェニルホ 量に対し300ppm(重量換算)の量で供給した。反 スフィンルテニウム0.075重量部を添加し、水素ガ 応中は、反応生成物を、毎時4kgの速度で反応容器か ス圧力100kg/ cm^2 ・G、温度165Cの条件 ら抜き出して、圧力300torr、温度105Cに保 50 で、4時間処理して、水素添加反応を行った。次いで、

得られた反応溶液400重量部とトルエン100重量部 を別の反応容器に仕込み、乳酸 0.71 重量部と水 1. 15重量部を添加して、60℃で30分間攪拌したの ち、メチルアルコール260重量部を添加して、60℃ でさらに1時間攪拌した。その後、反応容器を室温まで 冷却し、貧溶媒相(メチルアルコール相)と良溶媒相 (樹脂溶液相) とに分離させたのち、貧溶媒相のみを抜 き出した。その後、抜き出したメチルアルコールの4. 5重量%に相当するメチルアルコールと55重量%に相 当するトルエンとを、反応容器に添加して、60℃で1 10 時間攪拌した。その後、再び室温まで冷却して、貧溶媒 相と良溶媒相とに分離させ、貧溶媒相のみを抜き出し た。このメチルアルコールによる抽出操作を数回繰返し たのち、良溶媒相を分離し、良溶媒相から溶媒を留去し て、樹脂を回収した。次いで、この樹脂をテトラヒドロ フランに再溶解したのち、大量のメチルアルコールによ り再凝固させ、凝固した樹脂を減圧下で乾燥して、精製 樹脂を得た。この樹脂は、NMRスペクトルにより測定 した水素付加率が100%であり、下記式で表される繰 返し単位からなり、Mwが15,000のランダム共重 20 合体であった。この樹脂を、樹脂(AII-1)とする。

[0059]

【化12】

【0060】(4)加水分解

フラスコに、樹脂(AII-1)100重量部、プロピレングリコールモノエチルエーテル200重量部、蒸留水100重量部および水酸化カリウム10重量部を仕込み、窒素雰囲気中環流下で、36時間加水分解を行った。次

34

いで、反応溶液を冷却したのち、水酸化カリウムに対して1.1当量のしゅう酸2水和物を溶解した水溶液中に滴下して、樹脂を凝固させた。この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定した加水分解率が80%であり、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂(AIII-1)とする。

[0061]

【化13】

【0062】(5)保護基の導入

フラスコに、樹脂 (AIII-1)100重量部、乾燥テトラ ヒドロフラン200重量部、ジヒドロピラン100重量 部およびp-トルエンスルホン酸ピリジニウム塩2重量 部を仕込み、窒素雰囲気中室温で、36時間攪拌した。 次いで、酢酸エチル200重量部と蒸留水400重量部 を添加し、攪拌したのち、静置して、有機層を分離させ た。この有機層を数回水で洗浄したのち、テトラヒドロ フランと過剰のジヒドロピランを留去し、真空下で乾燥 して、精製樹脂を得た。この樹脂は、赤外吸収スペクト ルにより測定したテトラヒドロピラニルエステル基によ るエステル化率が95%であり、下記式(10-1)~ (10-3)で表される繰返し単位からなり、各繰返し 単位のモル比が、(10-1)/(10-2)/(10 (-3) = 20/4/76 (-3) = 20/4/76 (-3) = 20/4/76 (-3) = 20/4/76ランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (AIII-2) とする。

[0063]

【化14】

 \dots (10-3)

合成例1の(2)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、5-メチル-5-メトキシカルボニルビシク ロ[2.2.1] ヘプト-2-エン60重量部、8-メ チルー8-メトキシカルボニルテトラシクロ[4.4. 0.12.5.17.10]ドデカー3-エン40重量部、1 ーヘキセン (分子量調節剤) 25重量部、1,2ージク ロロエタン400重量部、メタセシス触媒としてトリエ チルアルミニウムのクロロベンゼン溶液(濃度1.5モ ル/リットル) 0.6 重量部と六塩化タングステンのク ロロベンゼン溶液(濃度10.025モル/リットル) 4 重量部を仕込み、80℃で3時間開環共重合させた。 重合終了後、重合溶液に大量のメタノールを加えて共重 合体を凝固させ、凝固した共重合体をろ別し、真空乾燥 して、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム 共重合体(収率92重量%)を得た。この共重合体を、 樹脂 (A-2) とする。

[0065]

【化15】

【0066】(2)水素付加

オートクレーブに、樹脂 (A-2) 100重量部と、水素 付加触媒として活性炭に担持させたロジウム(ロジウム 含有率5重量%) 10重量部を加えたのち、テトラヒド 30 ロフラン2000重量部に溶解し、水素圧を150kg / c m² として、150℃で5時間水素添加反応を行っ た。反応後、反応容器中の水素ガスを放出し、さらに反 応溶液から水素添加触媒をろ別したのち、メタノールを

【0070】(4)保護基の導入

フラスコ内で、樹脂 (AIII-3)100重量部を酢酸エチ

加えて、水素添加樹脂を凝固させた。次いで、この樹脂 をテトラヒドロフランに再溶解したのち、メタノールを 加えて樹脂を再凝固させ、凝固した樹脂をろ別し、真空 乾燥して、精製樹脂を得た。この樹脂は、赤外吸収スペ クトルおよびNMRスペクトルにより測定した水素付加 率が100%であり、下記各式で表される繰返し単位か らなるランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (AIV-1) とする。

[0067]

【化16】

【0068】(3)加水分解

オートクレーブ内で、樹脂 (AIV-1) 100重量部をテ トラヒドロフラン300重量部に溶解し、さらに水10 重量部、85重量%水酸化カリウム10重量部を加えた のち、140℃で、8時間加水分解反応を行った。次い で、反応溶液を冷却し、しゅう酸二水和物の10重量% 水溶液200重量部を加えて中和したのち、メチルイソ ブチルケトン500重量部により樹脂を抽出した。その 後、樹脂溶液層を2回水洗したのち、n-ヘキサンに注 いで樹脂を凝固させ、凝固した樹脂をろ別し、真空乾燥 して、精製樹脂を得た。この樹脂は、赤外吸収スペクト ルにより測定した加水分解率が70%であり、下記各式 で表される繰返し単位からなるランダム共重合体であっ た。この樹脂を、樹脂 (AIII-3)とする。

[0069]

【化17】

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ &$$

Hーピラン50重量部、反応触媒としてpートルエンス ルホン酸ピリジニウム塩3重量部を加えて、25℃で8 ル400重量部に溶解し、さらに3、4-ジヒドロ-2 50 時間反応を行った。次いで、水を加えたのち水層を分離

する操作を3回繰返して、酸成分を除去した。得られた 樹脂溶液をn-ヘキサンに注いで、樹脂を凝固させ、凝 固した樹脂をろ別し、真空乾燥して、精製樹脂を得た。 この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定したテトラ ヒドロピラニルオキシカルボニル基によるエステル化率 が85%であり、下記式(11-1)~(11-6)で 表される繰返し単位からなり、各繰返し単位のモル比 * *が、(11-1) / (11-2) / (11-3) / (1 1-4) / (11-5) / (11-6) = 20/6/39/21/11/3であり、Mwが32,000のラン ダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂 (AIII-4)と する。

[0071]

【化18】

30

... (11-4)

【0072】合成例3

(1) 重合

合成例1の(2)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、5-メチル-5-t-ブトキシカルボニルビ シクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン70重量部と 8, 9-ジカルボキシアンハイドライドテトラシクロ[4. 4. 0. 1^{2,5}. 1^{7,10}]ドデカー3-エン30重 量部、1-ヘキセン(分子量調節剤)20重量部、1, 2-ジクロロエタン400重量部、メタセシス触媒とし てジエチルアルミニウムクロライドのn-ヘキサン溶液 (濃度10重量%) 1. 7重量部と六塩化タングステン 40 のクロロベンゼン溶液 (濃度2重量%) 1.8重量部と パラアルデヒドの1, 2-ジクロロエタン溶液(濃度1 0重量%) 0.1重量部を仕込み、60℃で7時間開環 共重合させた。重合終了後、重合溶液に大量のメタノー ルを加えて共重合体を凝固させ、凝固した共重合体をろ 別し、真空乾燥して、下記各式で表される繰返し単位か らなるランダム共重合体(収率94重量%)を得た。こ の共重合体を、樹脂(A-3)とする。

[0073]

【0074】(2)水素付加

樹脂(A-3)を、合成例2の(2)と同様にして、水素 付加および精製処理をを行った。この樹脂は、赤外吸収 スペクトルおよびNMRスペクトルにより測定した水素 付加率が100%であり、下記式(12-1)~(12 -2)で表される繰返し単位からなり、各繰返し単位の モル比が、(12-1)/(12-2)=72/28で あり、Mwが29,000のランダム共重合体であっ た。この樹脂を、樹脂 (AII-2) とする。

[0075]

【化20】

 \dots (12-2)

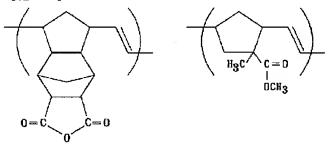
【0076】合成例4

(1) 重合

モノマーとして5-メチル-5-メトキシカルボニルビ シクロ[2.2.1]ヘプト-2-エン70重量部と 8, 9-ジカルボキシアンハイドライドテトラシクロ[4. 4. 0. 12.5. 17.10]ドデカー3-エン30重 量部、分子量調節剤として1-ヘキセン20重量部を用 いた以外は、合成例2の(1)と同様にして、下記各式 で表される繰返し単位からなるランダム共重合体(収率 90重量%)を得た。この共重合体を、樹脂(A-4)と する。

[0077]

【化21】



【0078】(2)水素付加

樹脂(A-4)を、合成例2の(2)と同様にして、水素 付加および精製処理を行った。この樹脂は、赤外吸収ス ペクトルおよびNMRスペクトルにより測定した水素付 加率が100%であり、下記各式で表される繰返し単位 からなり、Mwが27、000のランダム共重合体であ った。この樹脂を、樹脂(AII-3)とする。

[0079]

【化22】

【0080】(3)加水分解

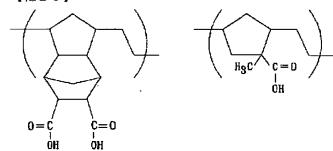
フラスコ内で、樹脂 (AII-3) 100重量部をテトラヒ 50 モノマーとして8-メチルー8-tーブトキシカルボニ

ドロフラン200重量部に溶解し、さらに水100重量 部を加えたのち、還流下で12時間加水分解反応を行っ た。次いで、反応溶液からテトラヒドロフランと水を留 去して、樹脂を得た。この樹脂は、赤外吸収スペクトル により測定した加水分解率が100%であり、下記各式 で表される繰返し単位からなるランダム共重合体であっ た。この樹脂を、樹脂 (A-5) とする。

40

[0081]

【化23】



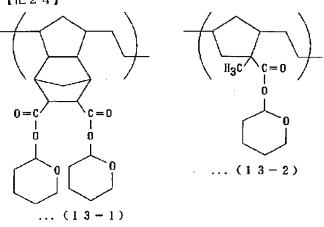
【0082】(4)保護基の導入

フラスコ内で、樹脂 (A-5) 100重量部を酢酸エチル 100重量部に溶解し、さらに3,4-ジヒドロ-2H ーピラン50重量部、反応触媒としてpートルエンスル ホン酸ピリジニウム塩2.5重量部を加えて、25℃で 14時間反応を行った。次いで、水を加えたのち水層を 分離する操作を3回繰返して、酸成分を除去した。得ら れた樹脂溶液をnーヘキサンに注いで、樹脂を凝固さ せ、凝固した樹脂をろ別し、真空乾燥して、精製樹脂を 得た。この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定した テトラヒドロピラニルオキシカルボニル基によるエステ ル化率が100%であり、下記式(13-1)~(13 30 - 2) で表される繰返し単位からなり、各繰返し単位の モル比が、(13-1)/(13-2)/=22/78 であり、Mwが25、000のランダム共重合体であっ た。この樹脂を、樹脂(AII-4)とする。

[0083]

【化24】

40



【0084】合成例5

(1) 重合

41

ルテトラシクロ[$4.4.0.1^{2.5}.1^{7.10}$]ドデカー3ーエン70重量部と5ーメチルー5ーフェノキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2ーエン30 重量部、分子量調節剤として1ーヘキセン18重量部を用いた以外は、合成例2の(1)と同様にして、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体(収率95重量%)を得た。この共重合体を、樹脂(A-6)とする。

[0085]

【化25】

【0086】(2)水素付加

樹脂 (A-6) を、合成例2の(2) と同様にして、水素付加および精製処理を行った。この樹脂は、赤外吸収スペクトルおよびNMRスペクトルにより測定した水素付加率が100%であり、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂(AIV-2) とする。

[0087]

【化26】

【0088】(3)加水分解

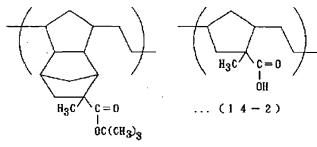
フラスコ内で、樹脂(AIV-2)100重量部をテトラヒドロフラン200重量部に溶解し、さらに2.38重量 40%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液50重量部を加えたのち、還流下で12時間加水分解反応を行った。次いで、反応溶液を冷却し、しゅう酸二水和物の10重量%水溶液15重量部を加えて中和したのち、酢酸エチル400重量部により樹脂を抽出した。その後、樹脂溶液層を3回水洗したのち、樹脂溶液をnーへキサンに注いで、樹脂を凝固させ、凝固した樹脂をろ別し、真空乾燥して、精製樹脂を得た。この樹脂は、NMRスペクトルにより、フェノキシカルボニル基が定量的に加水分解したことが確認され、下記式(14-1)~(150

4-2)で表される繰返し単位からなり、各繰返し単位のモル比が、 (14-1) / (14-2) / =18 / 8 2 であり、Mw が 31 , 000 のランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂(AIII-5)とする。

42

[0089]

【化27】



... (14-1)

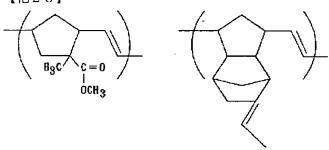
【0090】合成例6

(1) 重合

合成例1の(2)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、5ーメチルー5ーメトキシカルボニルビシク ロ[2.2.1]ペプトー2ーエン70重量部、8ーエ チリデンテトラシクロ[4.4.0.1²-5.1^{7.12}] ドデカー3ーエン30重量部、1ーヘキセン(分子量調 節剤)15重量部、1,2ージクロロエタン400重量 部、メタセシス触媒としてトリエチルアルミニウムのクロロベンゼン溶液(濃度1.5モル/リットル)0.6 重量部と六塩化タングステンのクロロベンゼン溶液(濃度10.025モル/リットル)4重量部を仕込み、80℃で3時間開環共重合させた。重合終了後、重合溶液に大量のメタノールを加えて共重合体を凝固させ、凝固 した共重合体をろ別し、真空乾燥して、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体(収率87重量%)を得た。この共重合体を、樹脂(A-7)とする。

[0091]

【化28】



【0092】(2)水素付加

樹脂(A-7)を、合成例2の(2)と同様にして、水素付加および精製処理を行った。この樹脂は、赤外吸収スペクトルおよびNMRスペクトルにより測定した水素付加率が100%であり、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂(AII-5)とする。

[0093]

【化29】

【0094】(3)加水分解および保護基の導入 樹脂(AII-5)を、合成例2の(3)と同様にして加水*

 \dots (15-1)

 \dots (15-3)

【0096】合成例7

(1) 重合

合成例2の(1)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、8-メチル-8-メトキシカルボニルテトラ シクロ[4.4.0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカ-3-エ ン216重量部、無水マレイン酸98重量部、アゾビス イソブチロニトリル16.4重量部、テトラヒドロフラ ン157重量部を仕込み、80℃で18時間共重合させ た。重合終了後、反応溶液を大量のメタノール中に注い で、共重合体を凝固させた。次いで、凝固した共重合体 をテトラヒドロフランに再溶解したのち、大量の10 キサン中に注いで、共重合体を再度凝固させ、凝固した 共重合体をる別し、真空乾燥して、下記式で表される繰 返し単位からなり、10 のの交互共重合体 (収率55重量%)を得た。この共重合体を、樹脂(10

II-a) とする。 【0097】

【化31】

*分解反応を行ったのち、合成例2の(4)と同様にしてエステル化反応を行った。この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定したテトラヒドロピラニル基によるエステル化率が70%であり、下記式(15-1)~(15-4)で表される繰返し単位からなり、各繰返し単位のモル比が、(15-1)/(15-2)/(15-3)/(15-4)=21/19/45/15であり、Mwが33,000のランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂(AIII-6)とする。

44

0 [0095]

【化30】

 \dots (15-2)

... (15-4)

【0098】(2)加溶媒分解

フラスコ内で、樹脂(AII-a)100重量部を、乾燥した t ーブチルアルコール500重量部に溶解したのち、 窒素雰囲気下、還流下で12時間反応させることにより、樹脂中の酸無水物基を加溶媒分解させてハーフエステルに変換して、下記式で表される繰返し単位からなり、Mwが5,400の交互共重合体を得た。この共重合体は、赤外吸収スペクトルおよびNMRスペクトルにより測定した結果、ハーフエステル化反応がほぼ定量的に進行していた。この共重合体を、樹脂(AII-b)とする。

50 [0099]

45

【0100】合成例8

(1) $5 - t - \vec{v} + \vec{$ 1] ヘプトー2ーエンおよび8ーtーブトキシカルボニ ルテトラシクロ[4. 4. 0. $1^{2.5}$. $1^{7.10}$]ドデカ - 3 - エンの合成

内容積2リットルのオートクレーブに、tーブチルアク リレート256.3g、ジシクロペンタジエン264. 4g、トルエン1040gを仕込み、170℃以上の温 度で5時間、反応を行った。次いで、反応生成物を抜き 出して、トルエンを留去したのち、蒸留塔を用い、8. OTorr、87℃で蒸留して、純度99.9重量%の 5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2.2.1]へ プトー2ーエンを250g得た。また、同一の蒸留塔を 用い、0.07Torr、97~102℃で蒸留して、 純度99.9重量%の8-t-ブトキシカルボニルテト ラシクロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー3ー エンを100g得た。

(2) 重合

合成例1の(2)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、5-t-ブトキシカルボニルビシクロ[2. 2. 1] ヘプト-2-エン40重量部、1-ヘキセン (分子量調節剤) 26重量部、トルエン80重量部を仕 込み、80℃に加熱した。次いで、メタセシス触媒とし てトリエチルアルミニウムのトルエン溶液(濃度0.1 23モル/リットル) 5. 4重量部とWCleのトルエン溶 液(濃度 0.025モル/リットル)3.4重量部を加 え、80℃で3時間攪拌して重合して、下記式で表され る繰返し単位からなる樹脂(収率60重量%)の溶液を

[0101]

【化33】

得た。この樹脂を、樹脂 (A-10)とする。

【0102】(3)水素添加

樹脂 (A-10)を、合成例1の(3)と同様にして、水素 付加および精製処理を行って、NMRスペクトルにより 50 46

測定した水素付加率が100%であり、下記式で表され る繰返し単位からなり、Mwが42,000の樹脂を得 た。この樹脂を、樹脂(AII-6)とする。

[0103]

【化34】

【0104】(4) 不純物の低減

樹脂(AII-6)のトルエン溶液を、トリエタノールアミ ンの5重量%水溶液と混合し、70℃で12時間攪拌し たのち、静置分離させて、水層を除去した。この操作を 10回繰返したのち、3回水洗した。次いで、樹脂層か らメチルアルコールにより樹脂を再凝固させ、凝固した 樹脂をろ過し、乾燥した。この樹脂を、樹脂 (AII-6 a)とする。樹脂(AII-6a)は、残留タングステン、 残留アルミニウムおよび残留ルテニウムそれぞれの含有 量が250ppb以下であり、残留塩素の含有量が50 ppb以下であった。これに対して、樹脂(AII-6) は、残留タングステンの含有量が6ppmであり、残留 塩素の含有量が10ppmであった。樹脂(AII-6a) および樹脂 (AII-6) の残留金属の含有量の定量は、各 樹脂をマッフル炉で焼成して、灰化したのち、セイコー 電子工業(株)製SPS7700誘導結合プラズマ発光 分光分析装置を用いて行った。また、残留塩素の含有量 の定量は、アルミニウム皿上に形成した各樹脂のフィル ムについて、フィリップス社製蛍光X線装置PW140 4型を用いて行った。

(5) 加水分解

フラスコに、樹脂(AII-6a)100重量部、プロピレ ングリコールモノエチルエーテル200重量部および2 0重量%硫酸10重量部を仕込み、窒素雰囲気中還流下 で、8時間加水分解を行った。次いで、反応溶液を冷却 したのち、水200重量部および酢酸エチル200重量 部を加えて、抽出操作を行った。その後、水200重量 部にて3回水洗したのち、大量のn-ヘキサン中に滴下 40 して、樹脂を再疑個させ、凝固した樹脂を、減圧下で乾 燥した。この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定し た結果、加水分解反応が定量的に進行しており、下記式 で表される繰返し単位からなる樹脂であった。この樹脂 を、樹脂 (A-11)とする。

[0105]

【化35】

【0106】(6)保護基の導入

フラスコに、樹脂 (A-11)100重量部、乾燥テトラヒ ドロフラン200重量部、ジヒドロピラン100重量部 およびpートルエンスルホン酸ピリジニウム塩2重量部 10 を仕込み、窒素雰囲気中室温で、48時間攪拌した。次 いで、酢酸エチル200重量部と蒸留水400重量部を 添加し、攪拌したのち、静置して、有機層を分離させ た。この有機層を数回水で洗浄したのち、テトラヒドロ フランと過剰のジヒドロピランを留去し、真空下で乾燥 して、精製樹脂を得た。この樹脂は、赤外吸収スペクト ルにより測定したテトラヒドロピラニルエステル基によ るエステル化率が98%であり、下記式(16-1)~ (16-2)で表される繰返し単位からなり、各繰返し 単位のモル比が、(16-1)/(16-2)=2/9 20 8であり、Mwが25,000、ガラス転移点が95℃ のランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂(AII I-7)とする。

[0107]

【化36】

【0108】合成例9

(1) 重合

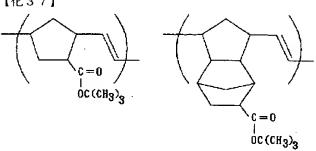
合成例1の(2)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、合成例8の(1)で得た5-t-ブトキシカ 40 ルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプトー2-エン60 重量部と8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4. 4. 0. 12.5. 17.10]ドデカー3-エン20重 量部、1-ヘキセン(分子量調節剤)12重量部、トル エン160重量部を仕込み、80℃に加熱した。次い で、メタセシス触媒としてトリエチルアルミニウムのト ルエン溶液(濃度0.123モル/リットル)15重量 部とWCleのトルエン溶液(濃度 0.025モル/リット ル) 9. 3重量部を加え、80℃で3時間攪拌して重合 して、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム 50

共重合体(収率50重量%)の溶液を得た。この樹脂 を、樹脂 (A-12)とする。

48

[0109]

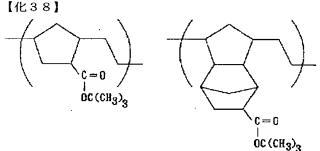
【化37】



【0110】(2)水素添加

樹脂 (A-12)を、合成例1の(3)と同様にして、水素 付加および精製処理を行って、NMRスペクトルにより 測定した水素付加率が100%であり、下記各式で表さ れる繰返し単位からなり、Mwが34,000のランダ ム共重合体を得た。この樹脂を、樹脂(AIV-3)とす る。

[0111]



【0112】(3)加水分解

フラスコに、樹脂 (AIV-3) 100重量部、プロピレン グリコールモノエチルエーテル200重量部および20 重量%硫酸10重量部を仕込み、窒素雰囲気中還流下 で、8時間加水分解を行った。次いで、反応溶液を冷却 したのち、水200重量部および酢酸エチル200重量 部を加えて、抽出操作を行った。その後、水200重量 部にて3回水洗したのち、大量のn-ヘキサン中に滴下 して、樹脂を再疑個させ、凝固した樹脂を、減圧下で乾 燥した。この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定し た結果、加水分解反応が定量的に進行しており、下記各 式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体であ った。この樹脂を、樹脂 (A-13)とする。

[0113]

【化39】

30

【0114】(4)保護基の導入

フラスコに、樹脂 (A-13) 1 0 0 重量部、乾燥テトラヒ 10 ドロフラン200重量部、ジヒドロピラン100重量部 およびpートルエンスルホン酸ピリジニウム塩2重量部 を仕込み、窒素雰囲気中30℃で、48時間攪拌した。 次いで、酢酸エチル200重量部と蒸留水400重量部*

[0115]

【化40】

(17-1)

$$(17-2)$$

(17-3)

(17-4)

【0116】合成例10

(1) 重合

合成例1の(2)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、合成例8 σ (1)で得た5-t-ブトキシカ 40 ルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン3 4. 3 重量部と8-t-ブトキシカルボニルテトラシク ロ[4. 4. 0. 1^{2.5}. 1^{7.10}]ドデカー3-エン4 5. 7重量部、1-ヘキセン (分子量調節剤) 22重量 部、トルエン160重量部を仕込み、80℃に加熱し た。次いで、メタセシス触媒としてトリエチルアルミニ ウムのトルエン溶液(濃度0.575モル/リットル) 4重量部とWCleのトルエン溶液(濃度 O. 025モル/ リットル) 11. 4重量部を加え、80℃で3時間攪拌 して重合して、下記各式で表される繰返し単位からなる 50 樹脂 (A-14)を、合成例1の(3)と同様にして、水素

ランダム共重合体(収率65重量%)の溶液を得た。こ の樹脂を、樹脂 (A-14)とする。

[0117]

【化41】

【0118】(2)水素添加

付加および精製処理を行って、NMRスペクトルにより 測定した水素付加率が100%であり、下記各式で表される繰返し単位からなり、Mwが28、000のランダ ム共重合体を得た。この樹脂を、樹脂(A1V-4)とす る。

[0119]

【化42】

【0120】(3)加水分解

フラスコに、樹脂(AIV-4)100重量部、プロピレングリコールモノエチルエーテル200重量部および20重量%硫酸10重量部を仕込み、窒素雰囲気中還流下で、8時間加水分解を行った。次いで、反応溶液を冷却20したのち、水200重量部および酢酸エチル200重量部を加えて、抽出操作を行った。その後、水200重量部にて3回水洗したのち、大量のn-ヘキサン中に滴下して、樹脂を再疑個させ、凝固した樹脂を、減圧下で乾燥した。この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定した結果、加水分解反応が定量的に進行しており、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体であった。この樹脂を、樹脂(A-15)とする。

[0121]

52

10 【0122】(4)保護基の導入

フラスコに、樹脂 (A-15)100重量部、乾燥テトラヒ ドロフラン200重量部、ジヒドロピラン100重量部 およびpートルエンスルホン酸ピリジニウム塩2重量部 を仕込み、窒素雰囲気中30℃で、48時間攪拌した。 次いで、酢酸エチル200重量部と蒸留水400重量部 を添加し、攪拌したのち、静置して、有機層を分離させ た。この有機層を数回水で洗浄したのち、テトラヒドロ フランと過剰のジヒドロピランを留去し、真空下で乾燥 して、精製樹脂を得た。この樹脂は、赤外吸収スペクト ルにより測定したテトラヒドロピラニルエステル基によ るエステル化率が98%であり、下記式(18-1)~ (18-4)で表される繰返し単位からなり、各繰返し 単位のモル比が、(18-1)/(18-2)/(18 -3)/(18-4) = 1/1/49/49 case, M wが27,000のランダム共重合体であった。この樹 脂を、樹脂 (AIII-9)とする。

[0123]

【化44】

(28)

(18 - 3)

C=0 0

(18-4)

【0124】合成例11

(1) 重合

合成例1の(2)で用いたセパラブルフラスコに、窒素 気流下で、合成例8の(1)で得た5-t-ブトキシカ ルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン40 重量部と8-t-ブトキシカルボニルテトラシクロ[4.4.0.1 $^{2.5}$.1 $^{7.10}$]ドデカ-3-エン20重 量部、5-メチル-5-メトキシカルボニルビシクロ[2.2.1] ヘプト-2-エン20重量部、1-ヘキセン(分子量調節剤)24重量部、トルエン160重量部* *を仕込み、80℃に加熱した。次いで、メタセシス触媒としてトリエチルアルミニウムのトルエン溶液(濃度0.123モル/リットル)15重量部とWCl₆のトルエン溶液(濃度0.025モル/リットル)9.3重量部を加え、80℃で3時間攪拌して重合して、下記各式で表される繰返し単位からなるランダム共重合体(収率70重量%)の溶液を得た。この樹脂を、樹脂(A-16)とする。

[0125]

【化45】

$$\begin{array}{c|c}
 & \text{OC } (\text{CH}^3)^3 \\
\hline
& \text{C} = 0 \\
& \text{C} = 0
\end{array}$$

【0126】(2)水素添加

樹脂 (A-16)を、合成例1の(3)と同様にして、水素付加および精製処理を行って、NMRスペクトルにより 測定した水素付加率が100%であり、下記各式で表さ れる繰返し単位からなるランダム共重合体を得た。この 樹脂を、樹脂(AIV-5)とする。

[0127]

【化46】

【0128】(3)加水分解

グリコールモノエチルエーテル200重量部および20 重量%硫酸10重量部を仕込み、窒素雰囲気中還流下 で、8時間加水分解を行った。次いで、反応溶液を冷却 したのち、水200重量部および酢酸エチル200重量 部を加えて、抽出操作を行った。その後、水200重量 部にて3回水洗したのち、大量のn-ヘキサン中に滴下 して、樹脂を再疑個させ、凝固した樹脂を、減圧下で乾*

*燥した。この樹脂は、赤外吸収スペクトルにより測定し フラスコに、樹脂 (AIV-5) 100重量部、プロピレン 10 た結果、加水分解反応が定量的に進行しており、下記式 (19-1)~(19-3)で表される繰返し単位から なり、各繰返し単位のモル比が、(19-1)/(19 -2)/(19-3) = 33/52/15 case Mw が32,000のランダム共重合体であった。この樹脂 を、樹脂 (AIII-10) とする。

[0129]

【化47】

[0130]

【実施例】

実施例1

合成例1で得た樹脂 (AII-1) のテトラヒドロフラン溶 液から形成した樹脂塗膜について、放射線透過率および エッチング速度を測定した。測定結果を、表1に示す。

【0131】実施例2

合成例1で得た樹脂 (AIII-2)のテトラヒドロフラン溶 液から形成した樹脂塗膜について、放射線透過率および エッチング速度を測定した。測定結果を、表1に示す。

【0132】実施例3

tーブチルメタクリレート、メチルメタクリレートおよ びメタクリル酸を、アゾイソブチロニトリルを重合開始 40 剤とし、tードデシルメルカプタンを連鎖移動剤とし て、重合し、tーブチルメタクリレート/メチルメタク リレート/メタクリル酸組成比が40/50/10で、 Mwが25,000の共重合体を得た。この共重合体 を、酸開裂性添加剤 (C1) とする。次いで、樹脂 (A III-2)50重量部、酸開裂性添加剂(C1)50重量部 およびトリフェニルスルホニウムトリフレート(酸発生 剤(B1))5重量部を、2-ヘプタノンと2-ヒドロ

キシプロピオン酸エチルとの80:20 (重量比) 混合 溶剤に溶解して、組成物溶液を調製した。この溶液を、 組成物溶液 (α) とする。組成物溶液 (α) から形成し たレジスト被膜について、放射線透過率およびエッチン グ速度を測定した。測定結果を、表1に示す。

【0133】比較例1

実施例3で得た酸開裂性添加剤 (C1) を2ーヒドロキ シプロピオン酸エチルに溶解した溶液から形成した樹脂 **塗膜について、エッチング速度を測定した。測定結果** を、表1に示す。

【0134】比較例2

Mwが5,000のクレゾールノボラック樹脂100重 量部と、2,3,4,4'-テトラヒドロキシベンゾフ ェノンの1,2ーキノンジアジド-5-スルホン酸エス テル (酸発生剤 (B2)) 25 重量部を、2-ヒドロキ シプロピオン酸エチルに溶解して、組成物溶液を調製し た。この溶液を、組成物溶液(β1)とする。組成物溶 液 (β1) から形成したレジスト被膜について、放射線 透過率を測定した。測定結果を、表1に示す。

[0135]

【表 1 】

表_1_

	樹脂	酸発生剤(B)	酸開製性 添加剤	放射線透过	エッチング	
	120, 112	EXPECENT (D)		248nm	193nm	速度 (Å/分)
実施例 1	AII-1	-	_	98.8	81.2	195
実施例2	A111-2	-		98.8	74.2	220
実施例 3	A111-2	B 1	Cı	98.9	78. 2	188
比較例 1	_	_	C1			410
比較例2	クレゾールノボ ラック検貼	В 2	_	25. 2	0. 02	-

【0136】実施例4

比較例2で得た組成物溶液 (β1)10gを2ーヒドロ キシプロピオン酸エチル20gでさらに希釈して、組成 物溶液 (β2) を調製したのち、シリコン基板上に塗布 し、温度300℃でベークを行って、膜厚0.1 μ mの **塗膜を形成した。この塗膜上に、実施例3で得た組成物** 溶液 (α) を塗布し、ベークを行って、膜厚 0. 6 μ m のレジスト被膜を形成したのち、このレジスト被膜上 に、ポリアクリル酸の水溶液を塗布して、上層膜を形成 20 した。次いで、得られた3層塗膜に、KェFエキシマレ ーザーステッパー((株)ニコン製NSR-2005 EX8A, 開口数0.50) を用いて露光したのち、露 光後ベークを行った。その後、2.38重量%テトラメ チルアンモニウムヒドロキシド水溶液を用いて現像し、 純水で洗浄し、乾燥したところ、線幅0.3μmのポジ 型ライン・アンド・スペースパターンが、良好な矩形状 で得られた。

【0137】実施例5~11

合成例 2 ~ 7 で得た樹脂 (AIII-4)、 (AII-2)、 (A 30 II-4)、 (AIII-5)、 (AIII-6)または (AII-b) を用い、下記する酸発生剤 (B)、ルイス塩基添加剤および溶剤と混合して、均一溶液としたのち、孔径 0.2 μ m のメンブランフィルターでろ過して、表 2 に示す組成物溶液 (但し、部は重量基準である。)を調製した。得ら*

*れた各組成物溶液について、現像条件を2.38重量% テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で1分間 現像(現像条件(i))または0.238重量%テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液で1分間現像 (現像条件(ii))

(現像条件(ii)) として、ポジ型レジストパターンを 形成したのち、各種評価を行った。評価結果を、表3に 示す。

酸発生剤(B)

20 B3:シクロヘキシルメチル (2-オキソシクロヘキシル) スルホニウムトリフレート

B4:4-ヒドロキシナフチルジメチルスルホニウムト リフレート

B5: トリフルオロメタンスルホニルビシクロ[2.

2. 1] ヘプト-5-エン-2, 3-ジカルボキシイミド

ルイス塩基添加剤

D1: トリn-ブチルアミン

D2:2-ヒドロキシピリジン

溶剤

E1:2-ヒドロキシプロピオン酸エチル

E2:酢酸nーブチル

E3:2-ヘプタノン

[0138]

【表2】

表 2

	樹脂(A) (部)	酸発生剤	(B) (部)		ス塩基 剤(部)	溶剤(部)
実施例5	AIII-4	(100)	B 4	(2.5)	Dl	(0.03)	E1/E3
実施例 6	A11-2	(100)	вз	(2.5)	D 2	(0.03)	(173/406) E 3 (580)
実施例7	AII-4	(100)	B 4	(2, 5)	D1	(0.03)	E 3 (580)
実施例8	AII-4	(100)	B 4	(2, 5)	Dl	(0.03)	E2/E3
実施例9	AİII-5	(100)	B 5	(2.5)	D 2	(0.03)	(173/406) E 1/E 3
実施例10	AIII-6	(100)	B 4	(2, 5)	Dl	(0.01)	(173/406) E 1/E 3
実施例11	AII-b	(100)	B 4	(2.5)	D 1	(0.01)	(173/406) E 1 (420)

[0139]

【表3】

表 3

	現像条件	放射線透過率 (193nm, %)	基板接着性	感度 (mJ/cm²)	解像度 (µm)	現像性
実施例 5	(ii)	6 3	良好	17	0.22	良好
実施例 6	(i)	6 8	良好	18	0. 22	良好
実施例7	(i)	7 1	良好	22	0. 22	良好
実施例8	(i i)	6 2	良好	1 5	0.24	良好
実施例 9	(i)	6 1	良好	8	0. 22	良好
実施例10	(i)	6 5	良好	2 3	0. 20	良好
実施例11	(H)	6 5	良好	3 5	0. 25	良 好

【0140】実施例12~17

合成例8~11で得た樹脂(AIII-7)、(A-11)、(A-1 3)、 (AIII-8)、 (AIII-9)、 (AIII-10) を用い、前 記した酸発生剤 (B4)、ルイス塩基添加剤 (D1) お よび溶剤(E3)と混合して、均一溶液としたのち、孔 径0. $2 \mu m$ のメンブランフィルターでろ過して、表 4に示す組成物溶液(但し、部は重量基準である。)を調 製した。得られた各組成物溶液について、(株)ニコン 20 【表4】 製ArFエキシマレーザー露光装置(レンズ開口数 0. *

*55)を用いた以外は、実施例4と同様にして、ポジ型 レジストパターンを形成したのち、各種評価を行った。 評価結果を、表5に示す。また、実施例12で得られた レジストパターンをホットプレート上で90℃に加熱し て、パターンの変形の程度を観察したところ、変形は全 くなく、耐熱性も優れていた。

60

[0141]

	樹脂 (A) (部)	酸発生剂	(B) (部)	ルイス塩基 添加剤 (部)	溶 剤 (部)
実施例12	AIII-7 (100)	B 4	(2.5)	D1 (0.01)	E 3 (500)
実施例13	A111-7 (70) A-11 (30)	B 4	(2.5)	D1 (0.01)	E 3 (500)
実施例14	A111-8 (100)	B 4	(2, 5)	D1 (0.01)	E 3 (500)
実施例15	A111-8 (50) A-13 (50)	B 4	(2.5)	D1 (0.01)	E 3 (500)
実施例16	AIII-9 (100)	B 4	(2.5)	D1 (0.01)	E 3 (500)
実施例17	AIII-9 (50) AIII-10 (50)	B 4	(2.5)	D1 (0.01)	E 3 (500)
実施例18	A11-6a (100)	B 4	(2, 5)	D1 (0.01)	E 3 (500)

[0142]

※ ※【表5】

	現像条件	放射線透過率 (193nm, %)	基板接着性	感度 (mJ/cm²)	解像度 (µm)	現像性
実施例12	(i)	6 4	良 好	2 6	0. 22	良好
実施例13	(i)	6 5	良 好	3 2	0. 20	良好
実施例14	(i)	. 66	良好	20	0. 22	良好
実施例15	(i)	64	良 好	2 5	0. 18	良好
実施例16	(i)	6 5	良 好	29	0. 18	良 好
実施例17	(i)	63	良 好	33	0.18	良好
実施例18	(1)	7 3	良 好	17	0. 18	良好

【0143】ここで、本発明の好ましい実施の形態態様 をまとめて示すと、以下のとおりである。

[1] 主鎖に一般式(1) または一般式(2) で表され 50 る脂環式骨格を有する樹脂 (A) および酸発生剤 (B)

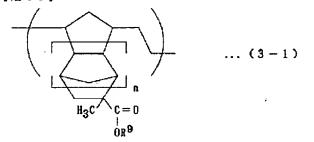
を含有する感放射線性樹脂組成物。

[2] 一般式(3) で表される繰返し単位を含有する樹脂(A) および酸発生剤(B) を含有する感放射線性樹脂組成物。

[3] 下記一般式 (3-1) で表される繰返し単位を含有する樹脂 (A) および酸発生剤 (B) を含有する感放射線性樹脂組成物。

[0144]

【化48】

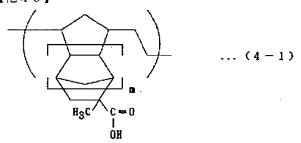


【0145】〔一般式 (3-1)において、nは0または1であり、R°は炭素数1~10の1価の炭化水素基、炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、カルボブトキシメチル基、カルボブトキシオチル基またはトリアルキルシリル基(但し、アルキル基の炭素数は1~4である。)を示す。〕

- 〔4〕一般式(3)で表される繰返し単位と一般式
- (4)で表される繰返し単位とを含有する樹脂(A)および酸発生剤(B)を含有する感放射線性樹脂組成物。
- [5] 前記一般式 (3-1) で表される繰返し単位と下記一般式 (4-1) で表される繰返し単位とを含有する樹脂 (A) および酸発生剤 (B) を含有する感放射線性 30樹脂組成物。

[0146]

【化49】



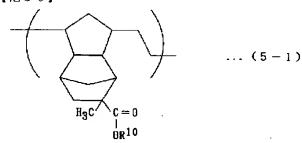
【0147】 [-般式(4-1) において、mは0または1である。]

- [6] 一般式(5)で表される繰返し単位と一般式
- (6)で表される繰返し単位とを含有する樹脂(A)および酸発生剤(B)を含有する感放射線性樹脂組成物。
- [7] 下記一般式 (5-1) で表される繰返し単位と下記一般式 (6-1) で表される繰返し単位とを含有する樹脂 (A) および酸発生剤 (B) を含有する感放射線性

樹脂組成物。

[0148]

【化50】



62

[0149]

$$\begin{array}{c|c}
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\
 & & \\$$

【0150】〔一般式 (5-1) および一般式 (6-1) において、R¹⁰ およびR¹¹ はそれぞれ独立に炭素数 1~10の1価の炭化水素基、炭素数1~10の1価のハロゲン化炭化水素基、テトラヒドロフラニル基、テトラヒドロピラニル基、カルボブトキシメチル基、カルボブトキシエチル基、カルボブトキシプロピル基またはトリアルキルシリル基(但し、アルキル基の炭素数は1~4である。)を示す。〕

- [8] 主鎖に前記一般式(1)で表され脂環式骨格を有する樹脂(A)および酸発生剤(B)を含有し、かつ該樹脂を製造する際に使用される触媒が、デミングの周期律表IV族、V族、VI族、VII 族およびVIII族の金属の群から選ばれる少なくとも1種を含むものであり、該樹脂中の残留金属の含有量が300ppb以下である感放射線性樹脂組成物。
- [9] 主鎖に前記一般式(1)で表され脂環式骨格を有する樹脂(A)および酸発生剤(B)を含有し、かつ該樹脂を製造する際に使用される触媒が、ふっ素、塩素および臭素の群から選ばれる少なくとも1種のハロゲンを含むものであり、該樹脂中の残留ハロゲンの含有量が3ppm以下である感放射線性樹脂組成物。

[0151]

【発明の効果】本発明の感放射線性樹脂組成物は、化学増幅型レジストとして、特に放射線に対する透明性およびドライエッチング耐性が優れ、しかも基板接着性、感度、解像度、現像性等にも優れたレジストパターンを形成することができるものであり、今後さらに微細化が進行すると予想される半導体デバイスの製造に極めて好適に使用することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 大田 利幸 東京都中央区築地二丁目11番24号 日本合 成ゴム株式会社内